

## บทที่ 5

### สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบและอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอเนกรูประหว่างวิธีชิปเทสต์ปรับใหม่ วิธีชิปเทสต์ วิธีแมนเทล-แฮนส์เซล และวิธีการถดถอยโลจิสติก โดยศึกษาภายใต้การจำลองข้อมูลด้วยการจัดกระทำปัจจัยที่แปรเปลี่ยน 4 ตัว คือ ลักษณะของข้อสอบ ความยาวของแบบสอบ สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน และขนาดกลุ่มตัวอย่าง ในแต่ละปัจจัยยังแบ่งออกเป็นระดับย่อย ๆ ดังนี้ ลักษณะของข้อสอบ 9 ลักษณะ (a ต่ำกับ b ต่ำ, a ต่ำกับ b ปานกลาง, a ต่ำกับ b สูง, a ปานกลางกับ b ต่ำ, a ปานกลางกับ b ปานกลาง, a ปานกลางกับ b สูง, a สูงกับ b ต่ำ, a สูงกับ b ปานกลาง และ a สูงกับ b สูง) ความยาวของแบบสอบ 2 ระดับ (30 ข้อ และ 60 ข้อ) สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน 3 ระดับ (5%, 10% และ 20%) และขนาดกลุ่มตัวอย่าง 6 ระดับ (จำนวนผู้สอบกลุ่มอ้างอิงต่อจำนวนผู้สอบกลุ่มเปรียบเทียบเท่ากับ 250 คนต่อ 250 คน, 500 คนต่อ 250 คน, 500 คนต่อ 500 คน, 1000 คนต่อ 250 คน, 1000 คนต่อ 500 คน และ 1000 คนต่อ 1000 คน)

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลจำลอง โดยใช้โปรแกรม IRTDATA (Johanson, 1992) จำลองข้อมูลภายใต้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ โมเดลโลจิสติกแบบ 3 พารามิเตอร์ชนิดกำหนดค่า c คงที่ (3PLM-c) แล้วนำข้อมูลที่จำลองไปจัดกระทำตามปัจจัยที่ศึกษา 4 ตัว ในการจัดกระทำข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยใช้โปรแกรม BILOG version 3.04 (Mislevy and Bock, 1990) ประมาณค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบ โดยเลือกโมเดลโลจิสติกแบบ 3 พารามิเตอร์ชนิดกำหนดค่า c คงที่ แล้วปรับเทียบสเกลพารามิเตอร์ของข้อสอบระหว่างผู้สอบกลุ่มอ้างอิงและกลุ่มเปรียบเทียบให้อยู่บนเมตริกซ์เดียวกันด้วยวิธีโค้งลักษณะแบบสอบ (test characteristic curve; TCC) ของ Stocking และ Lord (1983 cited in Kim and Cohen, 1992a) ภายใต้โมเดลโลจิสติกแบบ 2 พารามิเตอร์ โดยใช้โปรแกรม EQUATE version 2.0 (Baker, 1993) ต่อจากนั้นจึงตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอเนกรูป ( $\hat{a}_{iR} \neq \hat{a}_{iF}$ ) ด้วยวิธีการวัดพื้นที่ชนิดไม่คิดเครื่องหมายของ Raju (1990) ภายใต้โมเดลโลจิสติกแบบ 3 พารามิเตอร์ชนิดกำหนดค่า c คงที่ (3PLM-c) โดยใช้โปรแกรม IRTDIF version 1.0 (Kim and Cohen, 1992b) แล้วจึงนำผลการตรวจสอบดังกล่าวไปจัดกระทำข้อมูลตามปัจจัยที่ศึกษา 4 ตัว โดยใช้โปรแกรม SPSS for windows version 7.52 สุ่มข้อมูล รวมข้อมูลที่จัดกระทำทั้งหมด 324 เงื่อนไข ( $9 \times 2 \times 3 \times 6$ )

ผู้วิจัยนำข้อมูลที่จัดกระทำ 324 เงื่อนไข ไปคำนวณการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนุกรม 4 วิธี คือ วิธีชิปเทสต์ปรับปรุงใหม่ วิธีชิปเทสต์ วิธีแมนเทล-แฮนส์เซล และวิธีการถดถอยโลจิสติก โดยสองวิธีแรกใช้โปรแกรม SIBTEST ของ Stout และ Roussos version 1.1 (1992) วิธีต่อมาใช้โปรแกรม MHDIF version 1.0 (Fidalgo, 1995) และวิธีสุดท้ายใช้โปรแกรม SPSS/PC+ version 4.01

ในการวิเคราะห์ค่าอำนาจการทดสอบและอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีการตรวจสอบทั้ง 4 วิธีดังกล่าว ผู้วิจัยใช้วิธีการวัดพื้นที่ชนิดไม่คิดเครื่องหมายของ Raju เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ ส่วนการเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบและอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้ปัจจัยที่ศึกษา 4 ตัว ผู้วิจัยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 2 ทาง (two-way ANOVA) เพื่อทดสอบผลของวิธีการตรวจสอบ ผลของปัจจัยที่ศึกษา และผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการตรวจสอบและปัจจัยที่ศึกษา ถ้าผลการทดสอบดังกล่าวมีนัยสำคัญทางสถิติจะใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) ทดสอบในแต่ละระดับของตัวแปรแล้วเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการทดสอบของ Tukey ยกเว้นการเปรียบเทียบภายใต้ความยาวของแบบสอบ 2 ระดับจะใช้การทดสอบ t-test กรณีกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน (independent sample) โดยทดสอบใน 3 กรณีต่อไปนี้ (1) ทดสอบอำนาจการทดสอบและอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของแต่ละวิธีการตรวจสอบภายใต้ปัจจัยที่ศึกษาต่างระดับกัน (2) ทดสอบอำนาจการทดสอบและอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ระหว่างวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้ปัจจัยที่ศึกษาระดับเดียวกัน และ (3) ทดสอบอำนาจการทดสอบและอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ระหว่างวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้ปัจจัยที่ศึกษาต่างระดับกัน

### สรุปผลการวิจัย

ผลการเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบและอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนุกรมระหว่างวิธีชิปเทสต์ปรับปรุงใหม่ วิธีชิปเทสต์ วิธีแมนเทล-แฮนส์เซล และวิธีการถดถอยโลจิสติก โดยศึกษาภายใต้การจัดกระทำปัจจัย 4 ตัว คือ ลักษณะของข้อสอบ 9 ลักษณะ ความยาวของแบบสอบ 2 ระดับ สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน 3 ระดับ และขนาดกลุ่มตัวอย่าง 6 ระดับ สรุปรวมได้ดังตารางที่ 61, 62, 63 และ 64

ตารางที่ 61 สรุปผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของอำนาจการทดสอบ ( $p$ ) และอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ( $E_1$ ) ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนเนกูประหว่างวิธีการตรวจสอบ 4 วิธี ภายใต้ทุกเงื่อนไขของปัจจัยที่ศึกษา

ปัจจัย	วิธีการตรวจสอบ DIF							
	วิธี MSIB		วิธี SIB		วิธี MH		วิธี LR	
	P	$E_1$	P	$E_1$	P	$E_1$	P	$E_1$
TI								
$a_L, b_L$	26.36	9.50	18.03	2.94	19.17	4.53	24.33	9.94
$a_L, b_M$	53.22	10.64	12.69	5.00	19.22	6.31	39.75	9.25
$a_L, b_H$	27.53	10.78	22.89	4.28	18.53	7.39	22.39	9.33
$a_M, b_L$	25.11	9.28	6.72	4.39	5.78	4.92	15.54	8.06
$a_M, b_M$	45.81	7.36	25.17	4.17	29.14	3.69	49.28	6.19
$a_M, b_H$	10.86	8.64	5.11	5.64	5.53	5.56	30.69	8.17
$a_H, b_L$	8.08	7.92	1.83	3.89	15.97	2.31	19.48	6.36
$a_H, b_M$	37.64	7.56	16.61	3.58	26.08	3.75	49.75	5.36
$a_H, b_H$	23.17	8.25	10.92	4.89	8.61	5.64	19.69	7.92
TL								
30 ข้อ	28.17	9.62	13.05	4.84	16.77	5.07	31.38	8.04
60 ข้อ	29.12	8.14	13.61	3.78	16.12	4.73	28.82	7.64
%DIF								
5%	27.29	9.02	14.94	4.35	20.94	5.06	38.24	7.61
10%	30.08	7.87	14.19	4.64	17.13	5.19	31.00	7.63
20%	28.56	9.75	10.85	3.94	11.28	4.44	21.06	8.29
$N_R : N_F$								
250 : 250	20.00	8.69	9.09	4.69	10.80	5.52	24.38	9.28
500 : 250	21.09	10.00	10.17	4.61	12.72	4.69	22.63	8.09
500 : 500	30.41	9.04	12.63	4.56	13.09	4.67	27.93	8.63
1000 : 250	24.28	10.04	12.65	5.02	13.41	4.74	24.37	7.94
1000 : 500	33.94	8.24	14.17	3.59	22.54	5.61	34.54	6.93
1000 : 1000	42.13	7.28	21.28	3.39	26.13	4.17	46.76	6.19
ค่าเฉลี่ยรวม	28.64	8.88	13.33	4.31	16.45	4.90	30.10	7.84

ตารางที่ 62 สรุปผลการเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบ (p) และอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ( $E_1$ ) ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนุกรูปร่างของแต่ละวิธีการตรวจสอบ 4 วิธี ภายใต้เงื่อนไขของปัจจัยที่ศึกษาต่างระดับกัน

ปัจจัย		วิธีการตรวจสอบ DIF							
		วิธี MSIB		วิธี SIB		วิธี MH		วิธี LR	
		P	$E_1$	P	$E_1$	P	$E_1$	P	$E_1$
$\square a_L, b_L$	$\blacktriangle a_L, b_M$	-	0	0	0	0	0	0	0
	$\blacktriangle a_L, b_H$	0	0	0	0	0	-	0	0
	$\blacktriangle a_M, b_L$	0	0	0	0	0	0	0	0
	$\blacktriangle a_M, b_M$	-	0	0	0	0	0	-	+
	$\blacktriangle a_M, b_H$	0	0	+	-	0	0	0	0
	$\blacktriangle a_H, b_L$	0	0	+	0	0	0	0	+
	$\blacktriangle a_H, b_M$	0	0	0	0	0	0	-	+
	$\blacktriangle a_H, b_H$	0	0	0	0	0	0	0	0
$\square a_L, b_M$	$\blacktriangle a_L, b_L$	-	0	0	0	0	0	0	0
	$\blacktriangle a_L, b_H$	+	0	0	0	0	0	0	0
	$\blacktriangle a_M, b_L$	-	0	0	0	0	0	+	0
	$\blacktriangle a_M, b_M$	0	0	-	0	0	0	0	0
	$\blacktriangle a_M, b_H$	-	0	+	0	0	0	0	0
	$\blacktriangle a_H, b_L$	-	0	+	0	0	+	+	0
	$\blacktriangle a_H, b_M$	0	0	0	0	0	0	0	+
	$\blacktriangle a_H, b_H$	-	0	0	0	0	0	+	0
$\square a_L, b_H$	$\blacktriangle a_L, b_L$	0	0	0	0	0	+	0	0
	$\blacktriangle a_L, b_M$	-	0	0	0	0	0	0	0
	$\blacktriangle a_M, b_L$	0	0	+	0	0	0	0	0
	$\blacktriangle a_M, b_M$	0	0	0	0	0	+	-	+
	$\blacktriangle a_M, b_H$	0	0	+	0	0	0	0	0
	$\blacktriangle a_H, b_L$	-	0	+	0	0	+	0	0
	$\blacktriangle a_H, b_M$	0	0	0	0	0	+	-	+
	$\blacktriangle a_H, b_H$	0	0	+	0	0	0	0	0



ตารางที่ 62 (ต่อ)

ปัจจัย		วิธีการตรวจสอบ DIF							
		วิธี MSIB		วิธี SIB		วิธี MH		วิธี LR	
		P	E <sub>1</sub>	P	E <sub>1</sub>	P	E <sub>1</sub>	P	E <sub>1</sub>
□ a <sub>H</sub> , b <sub>L</sub>	▲ a <sub>L</sub> , b <sub>L</sub>	0	0	-	0	0	0	0	-
	▲ a <sub>L</sub> , b <sub>M</sub>	-	0	0	0	-	-	-	0
	▲ a <sub>L</sub> , b <sub>H</sub>	-	0	-	0	-	-	0	0
	▲ a <sub>M</sub> , b <sub>L</sub>	0	0	0	0	0	0	0	0
	▲ a <sub>M</sub> , b <sub>M</sub>	-	0	-	0	0	0	-	0
	▲ a <sub>M</sub> , b <sub>H</sub>	0	0	0	0	-	-	0	0
	▲ a <sub>H</sub> , b <sub>M</sub>	-	0	-	0	0	0	-	0
	▲ a <sub>H</sub> , b <sub>H</sub>	0	0	0	0	-	-	0	0
□ a <sub>H</sub> , b <sub>M</sub>	▲ a <sub>L</sub> , b <sub>L</sub>	0	0	0	0	0	0	+	-
	▲ a <sub>L</sub> , b <sub>M</sub>	0	0	0	0	0	0	0	-
	▲ a <sub>L</sub> , b <sub>H</sub>	0	0	0	0	0	-	+	-
	▲ a <sub>M</sub> , b <sub>L</sub>	0	0	0	0	+	0	+	0
	▲ a <sub>M</sub> , b <sub>M</sub>	0	0	0	0	0	0	0	0
	▲ a <sub>M</sub> , b <sub>H</sub>	+	0	0	0	+	0	0	0
	▲ a <sub>H</sub> , b <sub>L</sub>	+	0	+	0	0	0	+	0
	▲ a <sub>H</sub> , b <sub>H</sub>	0	0	0	0	+	0	+	0
□ a <sub>H</sub> , b <sub>H</sub>	▲ a <sub>L</sub> , b <sub>L</sub>	0	0	0	0	0	0	0	0
	▲ a <sub>L</sub> , b <sub>M</sub>	-	0	0	0	0	0	0	0
	▲ a <sub>L</sub> , b <sub>H</sub>	0	0	-	0	0	0	0	0
	▲ a <sub>M</sub> , b <sub>L</sub>	0	0	0	0	0	0	0	0
	▲ a <sub>M</sub> , b <sub>M</sub>	-	0	-	0	-	0	-	0
	▲ a <sub>M</sub> , b <sub>H</sub>	0	0	0	0	0	0	0	0
	▲ a <sub>H</sub> , b <sub>L</sub>	0	0	0	0	0	+	0	0
	▲ a <sub>H</sub> , b <sub>M</sub>	0	0	0	0	-	0	-	0

ตารางที่ 62 (ต่อ)

ปัจจัย		วิธีการตรวจสอบ DIF							
		วิธี MSIB		วิธี SIB		วิธี MH		วิธี LR	
		P	E <sub>1</sub>	P	E <sub>1</sub>	P	E <sub>1</sub>	P	E <sub>1</sub>
<input type="checkbox"/> 30 ข้อ	<input checked="" type="checkbox"/> 60 ข้อ	0	+	0	+	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 5%	<input checked="" type="checkbox"/> 10%	0	0	0	0	0	0	0	0
	<input checked="" type="checkbox"/> 20%	0	0	0	0	+	0	+	0
<input type="checkbox"/> 10%	<input checked="" type="checkbox"/> 5%	0	0	0	0	0	0	0	0
	<input checked="" type="checkbox"/> 20%	0	-	0	0	0	0	+	0
<input type="checkbox"/> 20%	<input checked="" type="checkbox"/> 5%	0	0	0	0	-	0	-	0
	<input checked="" type="checkbox"/> 10%	0	+	0	0	0	0	-	0
<input type="checkbox"/> 250 : 250	<input checked="" type="checkbox"/> 500 : 250	0	0	0	0	0	0	0	0
	<input checked="" type="checkbox"/> 500 : 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	<input checked="" type="checkbox"/> 1000 : 250	0	0	0	0	0	0	0	0
	<input checked="" type="checkbox"/> 1000 : 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	<input checked="" type="checkbox"/> 1000 : 1000	-	0	-	0	-	0	-	+
<input type="checkbox"/> 500 : 250	<input checked="" type="checkbox"/> 250 : 250	0	0	0	0	0	0	0	0
	<input checked="" type="checkbox"/> 500 : 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	<input checked="" type="checkbox"/> 1000 : 250	0	0	0	0	0	0	0	0
	<input checked="" type="checkbox"/> 1000 : 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	<input checked="" type="checkbox"/> 1000 : 1000	-	0	-	0	-	0	-	0
<input type="checkbox"/> 500 : 500	<input checked="" type="checkbox"/> 250 : 250	0	0	0	0	0	0	0	0
	<input checked="" type="checkbox"/> 500 : 250	0	0	0	0	0	0	0	0
	<input checked="" type="checkbox"/> 1000 : 250	0	0	0	0	0	0	0	0
	<input checked="" type="checkbox"/> 1000 : 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	<input checked="" type="checkbox"/> 1000 : 1000	0	0	0	0	-	0	-	-
<input type="checkbox"/> 1000 : 250	<input checked="" type="checkbox"/> 250 : 250	0	0	0	0	0	0	0	0
	<input checked="" type="checkbox"/> 500 : 250	0	0	0	0	0	0	0	0
	<input checked="" type="checkbox"/> 500 : 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	<input checked="" type="checkbox"/> 1000 : 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	<input checked="" type="checkbox"/> 1000 : 1000	-	0	0	0	-	0	-	0

ตารางที่ 62 (ต่อ)

ปัจจัย		วิธีการตรวจสอบ DIF							
		วิธี MSIB		วิธี SIB		วิธี MH		วิธี LR	
		P	E <sub>1</sub>	P	E <sub>1</sub>	P	E <sub>1</sub>	P	E <sub>1</sub>
□ 1000 : 500	▲ 250 : 250	0	0	0	0	0	0	0	0
	▲ 500 : 250	0	0	0	0	0	0	0	0
	▲ 500 : 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	▲ 1000 : 250	0	0	0	0	0	0	0	0
	▲ 1000 : 1000	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 1000 : 1000	▲ 250 : 250	+	0	+	0	+	0	+	-
	▲ 500 : 250	+	0	+	0	+	0	+	0
	▲ 500 : 500	0	0	0	0	+	0	+	-
	▲ 1000 : 250	+	0	0	0	+	0	+	0
	▲ 1000 : 500	0	0	0	0	0	0	0	0

- 0 หมายถึง P (หรือ E<sub>1</sub>) ของวิธีการตรวจสอบ DIF ภายใต้ปัจจัย □ มีค่าเท่ากับ P (หรือ E<sub>1</sub>) ของวิธีการตรวจสอบ DIF ภายใต้ปัจจัย ▲
- +
- หมายถึง P (หรือ E<sub>1</sub>) ของวิธีการตรวจสอบ DIF ภายใต้ปัจจัย □ มีค่าสูงกว่า P (หรือ E<sub>1</sub>) ของวิธีการตรวจสอบ DIF ภายใต้ปัจจัย ▲
- 
- หมายถึง P (หรือ E<sub>1</sub>) ของวิธีการตรวจสอบ DIF ภายใต้ปัจจัย □ มีค่าต่ำกว่า P (หรือ E<sub>1</sub>) ของวิธีการตรวจสอบ DIF ภายใต้ปัจจัย ▲



ตารางที่ 63 สรุปผลการเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบ  
อเนกรูประหว่างวิธีการตรวจสอบ 4 วิธี ภายใต้เงื่อนไขของปัจจัยที่ศึกษาระดับเดียวกัน

ปัจจัย	วิธีการตรวจสอบ DIF											
	■ วิธี MSIB			■ วิธี SIB			■ วิธี MH			■ วิธี LR		
	● วิธี SIB	● วิธี MH	● วิธี LR	● วิธี MSIB	● วิธี MH	● วิธี LR	● วิธี MSIB	● วิธี SIB	● วิธี LR	● วิธี MSIB	● วิธี SIB	● วิธี MH
$a_L, b_L$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$a_L, b_M$	+	+	0	-	0	-	-	0	-	0	+	+
$a_L, b_H$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$a_M, b_L$	+	+	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0
$a_M, b_M$	+	0	0	-	0	-	0	0	-	0	+	+
$a_M, b_H$	0	0	-	0	0	-	0	0	-	+	+	+
$a_H, b_L$	0	0	-	0	-	-	0	+	0	+	+	0
$a_H, b_M$	+	0	0	-	0	-	0	0	-	0	+	+
$a_H, b_H$	+	+	0	-	0	0	-	0	-	0	0	+
30 ข้อ	+	+	0	-	0	-	-	0	-	0	+	+
60 ข้อ	+	+	0	-	0	-	-	0	-	0	+	+
5%	+	0	0	-	0	-	0	0	-	+	+	+
10%	+	+	0	-	0	-	-	0	-	0	+	+
20%	+	+	+	-	0	-	-	0	-	-	+	+
250 : 250	+	+	0	-	0	-	-	0	-	0	+	+
500 : 250	+	0	0	-	0	-	0	0	-	0	+	+
500 : 500	+	+	0	-	0	-	-	0	-	0	+	+
1000 : 250	+	+	0	-	0	-	-	0	-	0	+	+
1000 : 500	+	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
1000 : 1000	+	0	0	-	0	-	0	0	-	0	+	+

0 หมายถึง P ของวิธีการตรวจสอบ ■ มีค่าเท่ากับ P ของวิธีการตรวจสอบ ●

+ หมายถึง P ของวิธีการตรวจสอบ ■ มีค่าสูงกว่า P ของวิธีการตรวจสอบ ●

- หมายถึง P ของวิธีการตรวจสอบ ■ มีค่าต่ำกว่า P ของวิธีการตรวจสอบ ●

ตารางที่ 64 สรุปผลการเปรียบเทียบอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนุกรมระหว่างวิธีการตรวจสอบ 4 วิธี ภายใต้เงื่อนไขของปัจจัยที่ศึกษาระดับเดียวกัน

ปัจจัย	วิธีการตรวจสอบ DIF											
	■ วิธี MSIB			■ วิธี SIB			■ วิธี MH			■ วิธี LR		
	● วิธี SIB	● วิธี MH	● วิธี LR	● วิธี MSIB	● วิธี MH	● วิธี LR	● วิธี MSIB	● วิธี SIB	● วิธี LR	● วิธี MSIB	● วิธี SIB	● วิธี MH
$a_L, b_L$	+	+	0	-	0	-	-	0	-	0	+	+
$a_L, b_M$	+	+	0	-	0	-	-	0	-	0	+	+
$a_L, b_H$	+	+	0	+	-	-	-	+	0	0	+	0
$a_M, b_L$	+	+	0	-	0	-	-	0	-	0	+	+
$a_M, b_M$	+	+	0	-	0	0	-	0	-	0	0	+
$a_M, b_H$	+	+	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0
$a_H, b_L$	+	+	0	-	0	-	-	0	-	0	+	+
$a_H, b_M$	+	+	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0
$a_H, b_H$	+	+	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0
30 ข้อ	+	+	+	-	0	-	-	0	-	-	+	+
60 ข้อ	+	+	0	-	0	-	-	0	-	0	+	+
5%	+	+	0	-	0	-	-	0	-	0	+	+
10%	+	+	0	-	0	-	-	0	-	0	+	+
20%	+	+	0	-	0	-	-	0	-	0	+	+
250 : 250	+	+	0	-	0	-	-	0	-	0	+	+
500 : 250	+	+	0	-	0	-	-	0	-	0	+	+
500 : 500	+	+	0	-	0	-	-	0	-	0	+	+
1000 : 250	+	+	0	-	0	-	-	0	-	0	+	+
1000 : 500	+	+	0	-	-	-	-	+	0	0	+	0
1000 : 1000	+	+	0	-	0	-	-	0	-	0	+	+

0 หมายถึง  $E_1$  ของวิธีการตรวจสอบ ■ มีค่าเท่ากับ  $E_1$  ของวิธีการตรวจสอบ ●

+

หมายถึง  $E_1$  ของวิธีการตรวจสอบ ■ มีค่าสูงกว่า  $E_1$  ของวิธีการตรวจสอบ ●

- หมายถึง  $E_1$  ของวิธีการตรวจสอบ ■ มีค่าต่ำกว่า  $E_1$  ของวิธีการตรวจสอบ ●

## ผลการวิจัยสรุปเป็น 2 ประเด็นใหญ่ ๆ ดังนี้

1. การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนุกรมระหว่างวิธีชิปเทสท์ปรับปรุงใหม่ วิธีชิปเทสท์ วิธีแมนเทล-แฮนส์เซล และวิธีการถดถอยโลจิสติก ภายใต้เงื่อนไขของปัจจัยที่ศึกษา ปรากฏผลดังนี้

1.1 ปัจจัยทางด้านลักษณะของข้อสอบมีผลต่ออำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสท์ปรับปรุงใหม่ วิธีชิปเทสท์ วิธีแมนเทล-แฮนส์เซล และวิธีการถดถอยโลจิสติก กล่าวคือ เมื่อลักษณะของข้อสอบ a ต่ำกับ b ปานกลางจะส่งผลให้อำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสท์ปรับปรุงใหม่มีค่าสูงสุด เมื่อลักษณะของข้อสอบ a ปานกลางกับ b ปานกลางจะส่งผลให้อำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสท์และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลมีค่าสูงสุด เมื่อลักษณะของข้อสอบ a สูงกับ b ปานกลางจะส่งผลให้อำนาจการทดสอบของวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าสูงสุด เมื่อพิจารณาในทุกเงื่อนไขของลักษณะของข้อสอบ ปรากฏว่า อำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสท์ปรับปรุงใหม่ วิธีแมนเทล-แฮนส์เซล และวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าเพิ่มขึ้นในทุกเงื่อนไขของลักษณะของข้อสอบที่มีค่าความยากปานกลาง ( $a_L, b_M; a_M, b_M$  และ  $a_H, b_M$ )

1.2 ปัจจัยทางด้านความยาวของแบบสอบไม่มีผลต่ออำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสท์ปรับปรุงใหม่ วิธีชิปเทสท์ วิธีแมนเทล-แฮนส์เซล และวิธีการถดถอยโลจิสติก

1.3 ปัจจัยทางด้านสัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันไม่มีผลต่ออำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสท์ปรับปรุงใหม่และวิธีชิปเทสท์ แต่จะมีผลต่ออำนาจการทดสอบของวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลและวิธีการถดถอยโลจิสติก กล่าวคือ เมื่อสัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันมีจำนวนลดลงจาก 20% เป็น 5% จะส่งผลให้อำนาจการทดสอบของ 2 วิธีดังกล่าวมีค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 10% และ 17% ตามลำดับ

1.4 ปัจจัยทางด้านขนาดกลุ่มตัวอย่างมีผลต่ออำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสท์ปรับปรุงใหม่ วิธีชิปเทสท์ วิธีแมนเทล-แฮนส์เซล และวิธีการถดถอยโลจิสติก กล่าวคือ เมื่อขนาดกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้นจาก  $N_R : N_F = 250 : 250$  เป็น  $N_R : N_F = 1000 : 1000$  จะส่งผลให้อำนาจการทดสอบของทั้ง 4 วิธีดังกล่าวมีค่าเพิ่มขึ้นสูงสุด โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 22%, 12%, 15% และ 22% ตามลำดับ

1.5 ภายใต้เงื่อนไขของปัจจัยที่แตกต่างกันทางด้านลักษณะของข้อสอบ ความยาวของแบบสอบ สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน และขนาดกลุ่มตัวอย่าง ปรากฏว่า อำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสท์ปรับปรุงใหม่และวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าสูงใกล้เคียงกันภายใต้เงื่อนไข

ทุกเงื่อนไข ส่วนอำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสท์และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลมีค่าต่ำใกล้เคียงกัน ภายใต้เกือบทุกเงื่อนไข ทั้งวิธีชิปเทสท์ปรับปรุงใหม่และวิธีการถดถอยโลจิสติกมีอำนาจการทดสอบสูงกว่าวิธีชิปเทสท์และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ภายใต้เกือบทุกเงื่อนไข

2. การเปรียบเทียบอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนุกรมระหว่างวิธีชิปเทสท์ปรับปรุงใหม่ วิธีชิปเทสท์ วิธีแมนเทล-แฮนส์เซล และวิธีการถดถอยโลจิสติก ภายใต้เงื่อนไขของปัจจัยที่ศึกษา ปรากฏผลดังนี้

2.1 ปัจจัยทางด้านลักษณะของข้อสอบมีผลต่ออัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสท์ วิธีแมนเทล-แฮนส์เซล และวิธีการถดถอยโลจิสติก กล่าวคือ เมื่อลักษณะของข้อสอบ a ปานกลางกับ b สูงจะส่งผลให้อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสท์มีค่าสูงสุด เมื่อลักษณะของข้อสอบ a ต่ำกับ b สูงจะส่งผลให้อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลมีค่าสูงสุด เมื่อลักษณะของข้อสอบ a ต่ำกับ b ต่ำจะส่งผลให้อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าสูงสุด เมื่อพิจารณาในทุกเงื่อนไขของลักษณะของข้อสอบ พบว่า อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าเพิ่มขึ้นในทุกเงื่อนไขของลักษณะของข้อสอบที่มีค่าอำนาจจำแนกต่ำ ( $a_L, b_L; a_M, b_M$  และ  $a_H, b_H$ )

2.2 ปัจจัยทางด้านความยาวของแบบสอบไม่มีผลต่ออัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีแมนเทล-แฮนส์เซล และวิธีการถดถอยโลจิสติก แต่จะมีผลต่อวิธีชิปเทสท์ปรับปรุงใหม่และวิธีชิปเทสท์ กล่าวคือ เมื่อเพิ่มความยาวของแบบสอบจาก 30 ข้อ เป็น 60 ข้อ จะส่งผลให้อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของ 2 วิธีดังกล่าวมีค่าลดลงต่ำสุด โดยลดลงประมาณ 1% เท่ากันทั้ง 2 วิธี

2.3 ปัจจัยทางด้านสัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันไม่มีผลต่ออัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสท์ วิธีแมนเทล-แฮนส์เซล และวิธีการถดถอยโลจิสติก แต่จะมีผลต่อวิธีชิปเทสท์ปรับปรุงใหม่ กล่าวคือ เมื่อสัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันมีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 10% เป็น 20% จะส่งผลให้อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีดังกล่าวมีค่าเพิ่มขึ้นสูงสุด โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 2%

2.4 ปัจจัยทางด้านขนาดกลุ่มตัวอย่างไม่มีผลต่ออัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสท์ปรับปรุงใหม่ วิธีชิปเทสท์ และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซล แต่จะมีผลต่อวิธีการถดถอยโลจิสติก กล่าวคือ เมื่อขนาดกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้นจาก  $N_R : N_F = 250 : 250$  เป็น  $N_R : N_F =$

1000 : 1000 จะส่งผลให้อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีดังกล่าวมีค่าลดลงต่ำสุด โดยลดลงประมาณ 3%

2.5 ภายใต้เงื่อนไขของปัจจัยที่แตกต่างกันทางด้านลักษณะของข้อสอบ ความยาวของแบบสอบ สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันและขนาดกลุ่มตัวอย่าง ปรากฏว่า อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสต์ปรับใหม่และวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าสูงใกล้เคียงกัน ภายใต้เกือบทุกเงื่อนไข ส่วนอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสต์และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลมีค่าต่ำใกล้เคียงกันภายใต้เกือบทุกเงื่อนไข ทั้งวิธีชิปเทสต์ปรับใหม่และวิธีการถดถอยโลจิสติกมีอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 สูงกว่าวิธีชิปเทสต์และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ภายใต้เกือบทุกเงื่อนไข

เมื่อเปรียบเทียบอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้เงื่อนไขของปัจจัยที่ศึกษา 324 เงื่อนไขกับเกณฑ์ของอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ที่ระดับ 10% พบว่า อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสต์ปรับใหม่ วิธีชิปเทสต์วิธีแมนเทล-แฮนส์เซล และวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าอยู่ภายในเกณฑ์ที่กำหนดดังกล่าว

เมื่อพิจารณาภาพรวมของการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนุกรมระหว่างวิธีชิปเทสต์ปรับใหม่ วิธีชิปเทสต์ วิธีแมนเทล-แฮนส์เซลและวิธีการถดถอยโลจิสติกภายใต้เงื่อนไขของปัจจัยที่แตกต่างกันทางด้านลักษณะของข้อสอบ ความยาวของแบบสอบ สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน และขนาดกลุ่มตัวอย่าง พบว่า วิธีชิปเทสต์ปรับใหม่และวิธีการถดถอยโลจิสติกมีความถูกต้องแม่นยำในการตรวจสอบได้เท่าเทียมกัน และทั้ง 2 วิธีมีความถูกต้องแม่นยำในการตรวจสอบสูงกว่าวิธีชิปเทสต์และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซล

### รายละเอียดของผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนเนกรูประหว่างวิธีชิปเทสท์ปรับใหม่ วิธีชิปเทสท์ วิธีแมนเทล-แฮนส์เซล และวิธีการถดถอยโลจิสติก ภายใต้เงื่อนไขของปัจจัยที่ศึกษา ปรากฏผลดังนี้

1.1 การตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนเนกรูปภายใต้ลักษณะของข้อสอบต่างกัน 9 ลักษณะ พบว่า อำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสท์ปรับใหม่ภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_L, b_M$  มีค่าสูงสุด (ประมาณร้อยละ 53.22) รองลงมาได้แก่ภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_M, b_M; a_H, b_M; a_L, b_H; a_L, b_L; a_M, b_L; a_H, b_H; a_M, b_H$  และ  $a_H, b_L$  ตามลำดับ (ประมาณร้อยละ 45.81, 37.64, 27.53, 26.36, 25.11, 23.17, 10.86 และ 8.08 ตามลำดับ) สำหรับวิธีชิปเทสท์ พบว่า อำนาจการทดสอบภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_M, b_M$  มีค่าสูงสุด (ประมาณร้อยละ 25.17) รองลงมาได้แก่ภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_L, b_H; a_L, b_L; a_H, b_M; a_L, b_M; a_H, b_H; a_M, b_L; a_M, b_H$  และ  $a_H, b_L$  ตามลำดับ (ประมาณร้อยละ 22.89, 18.03, 16.61, 12.69, 10.92, 6.72, 5.11 และ 1.83 ตามลำดับ) ส่วนวิธีแมนเทล-แฮนส์เซล พบว่า อำนาจการทดสอบภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_M, b_M$  มีค่าสูงสุด (ประมาณร้อยละ 29.14) รองลงมาได้แก่ภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_H, b_M; a_L, b_M; a_L, b_L; a_L, b_H; a_H, b_L; a_H, b_H; a_M, b_L$  และ  $a_M, b_H$  ตามลำดับ (ประมาณร้อยละ 26.08, 19.22, 19.17, 18.53, 15.97, 8.61, 5.78 และ 5.53 ตามลำดับ) สำหรับวิธีการถดถอยโลจิสติก พบว่า อำนาจการทดสอบภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_H, b_M$  มีค่าสูงสุด (ประมาณร้อยละ 49.75) รองลงมาได้แก่ภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_M, b_M; a_L, b_M; a_M, b_H; a_L, b_L; a_L, b_H; a_H, b_H; a_H, b_L$  และ  $a_M, b_L$  ตามลำดับ (ประมาณร้อยละ 49.28, 39.75, 30.69, 24.33, 22.39, 19.69, 19.48 และ 15.54 ตามลำดับ) เมื่อเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบระหว่างวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีดังกล่าวภายใต้ลักษณะของข้อสอบต่างกัน 9 ลักษณะ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 2 ทาง พบว่า ผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการตรวจสอบและลักษณะของข้อสอบมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นจึงเปรียบเทียบ 3 กรณี คือ (1) เปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของแต่ละวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้ลักษณะของข้อสอบต่างกัน 9 ลักษณะ (2) เปรียบเทียบอำนาจการทดสอบระหว่างวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้ลักษณะของข้อสอบเดียวกัน 9 ลักษณะ และ (3) เปรียบเทียบอำนาจการทดสอบระหว่างวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้ลักษณะของข้อสอบต่างกัน 9 ลักษณะ ผลปรากฏดังนี้

**กรณีที่ 1** เมื่อเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของแต่ละวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้ลักษณะของข้อสอบต่างกัน 9 ลักษณะ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ปรากฏว่า มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอเนกรูป ลักษณะของข้อสอบมีผลต่ออำนาจการทดสอบของวิธีการตรวจสอบทั้ง 4 วิธี ดังนั้นจึงนำอำนาจการทดสอบของแต่ละวิธีการตรวจสอบทั้ง 4 วิธีภายใต้ลักษณะของข้อสอบต่างกัน 9 ลักษณะมาเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการทดสอบของ Tukey ผลปรากฏว่า

อำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสท์ปรับปรุงใหม่ภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_L, b_M$  มีค่าสูงกว่าอำนาจการทดสอบภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_L, b_L; a_L, b_H; a_M, b_L; a_M, b_H; a_H, b_L$  และ  $a_H, b_H$  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สำหรับอำนาจการทดสอบภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_M, b_M$  มีค่าสูงกว่าอำนาจการทดสอบภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_L, b_L; a_M, b_L; a_M, b_H; a_H, b_L$  และ  $a_H, b_H$  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สำหรับอำนาจการทดสอบภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_H, b_M$  มีค่าสูงกว่าอำนาจการทดสอบภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_M, b_H$  และ  $a_H, b_L$  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สำหรับอำนาจการทดสอบภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_L, b_H$  มีค่าสูงกว่าอำนาจการทดสอบภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_H, b_L$  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอำนาจการทดสอบภายใต้ลักษณะของข้อสอบคู่อื่น ๆ ที่เหลือมีค่าไม่แตกต่างกัน

อำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสท์ภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_M, b_M$  มีค่าสูงกว่าอำนาจการทดสอบภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_L, b_M; a_M, b_L; a_M, b_H; a_H, b_L$  และ  $a_H, b_H$  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอำนาจการทดสอบภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_L, b_H$  มีค่าสูงกว่าอำนาจการทดสอบภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_M, b_L; a_M, b_H; a_H, b_L$  และ  $a_H, b_H$  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอำนาจการทดสอบภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_L, b_L$  มีค่าสูงกว่าอำนาจการทดสอบภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_M, b_H$  และ  $a_H, b_L$  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สำหรับอำนาจการทดสอบภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_H, b_M$  มีค่าสูงกว่าอำนาจการทดสอบภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_H, b_L$  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอำนาจการทดสอบภายใต้ลักษณะของข้อสอบคู่อื่น ๆ ที่เหลือมีค่าไม่แตกต่างกัน

อำนาจการทดสอบของวิธีแมนเทิล-แฮนส์เซลภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_M$ ,  $b_M$  และ  $a_H$ ,  $b_M$  มีค่าสูงกว่าอำนาจการทดสอบภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_M$ ,  $b_L$ ;  $a_M$ ,  $b_H$  และ  $a_H$ ,  $b_H$  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอำนาจการทดสอบภายใต้ลักษณะของข้อสอบ คู่อื่น ๆ ที่เหลือมีค่าไม่แตกต่างกัน

อำนาจการทดสอบของวิธีการถดถอยโลจิสติกภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_M$ ,  $b_M$  และ  $a_H$ ,  $b_M$  มีค่าสูงกว่าอำนาจการทดสอบภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_L$ ,  $b_L$ ;  $a_L$ ,  $b_H$ ;  $a_M$ ,  $b_L$ ;  $a_M$ ,  $b_H$ ;  $a_H$ ,  $b_L$  และ  $a_H$ ,  $b_H$  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สำหรับอำนาจการทดสอบ ภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_L$ ,  $b_M$  มีค่าสูงกว่าอำนาจการทดสอบภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_M$ ,  $b_L$ ;  $a_H$ ,  $b_L$  และ  $a_H$ ,  $b_H$  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอำนาจการทดสอบภายใต้ ลักษณะของข้อสอบคู่อื่น ๆ ที่เหลือมีค่าไม่แตกต่างกัน

กรณีที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบระหว่างวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้ ลักษณะของข้อสอบเดียวกัน 9 ลักษณะ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ปรากฏว่า ภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_L$ ,  $b_L$  และ  $a_L$ ,  $b_H$  อำนาจการทดสอบในการตรวจสอบ การทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนุกรมระหว่างวิธีชิปเทสต์ปรับใหม่ วิธีชิปเทสต์ วิธีแมนเทิล-แฮนส์เซล และวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าไม่แตกต่างกัน ส่วนภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_L$ ,  $b_M$ ;  $a_M$ ,  $b_L$ ;  $a_M$ ,  $b_M$ ;  $a_M$ ,  $b_H$ ;  $a_H$ ,  $b_L$ ;  $a_H$ ,  $b_M$  และ  $a_H$ ,  $b_H$  มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นจึงนำอำนาจการทดสอบระหว่างวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้ลักษณะของ ข้อสอบดังกล่าวมาเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการทดสอบของ Tukey ผลปรากฏว่า

ภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_L$ ,  $b_M$  อำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสต์ปรับใหม่และ วิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าสูงกว่าอำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสต์และวิธีแมนเทิล-แฮนส์เซล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอำนาจการทดสอบระหว่างวิธีการตรวจสอบคู่อื่น ๆ ที่เหลือมีค่าไม่แตกต่างกัน

ภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_M$ ,  $b_L$  อำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสต์ปรับใหม่มีค่า สูงกว่าอำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสต์และวิธีแมนเทิล-แฮนส์เซลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ส่วนอำนาจการทดสอบระหว่างวิธีการตรวจสอบคู่อื่น ๆ ที่เหลือมีค่าไม่แตกต่างกัน

ภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_M$ ,  $b_M$  อำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสต์ปรับใหม่มีค่า สูงกว่าอำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสต์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สำหรับอำนาจการ- ทดสอบของวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าสูงกว่าอำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสต์และวิธีแมนเทิล-



แฮนส์เซลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอำนาจการทดสอบระหว่างวิธีการตรวจสอบคู่อื่น ๆ ที่เหลือมีค่าไม่แตกต่างกัน

ภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_M, b_H$  อำนาจการทดสอบของวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าสูงกว่าอำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสต์ปรับใหม่ วิธีชิปเทสต์ และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอำนาจการทดสอบระหว่างวิธีการตรวจสอบคู่อื่น ๆ ที่เหลือมีค่าไม่แตกต่างกัน

ภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_H, b_L$  อำนาจการทดสอบของวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าสูงกว่าอำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสต์ปรับใหม่และวิธีชิปเทสต์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอำนาจการทดสอบของวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลมีค่าสูงกว่าอำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสต์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอำนาจการทดสอบระหว่างวิธีการตรวจสอบคู่อื่น ๆ ที่เหลือมีค่าไม่แตกต่างกัน

ภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_H, b_M$  อำนาจการทดสอบของวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าสูงกว่าอำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสต์และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สำหรับอำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสต์ปรับใหม่มีค่าสูงกว่าอำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสต์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอำนาจการทดสอบระหว่างวิธีการตรวจสอบคู่อื่น ๆ ที่เหลือมีค่าไม่แตกต่างกัน

ภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_H, b_H$  อำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสต์ปรับใหม่มีค่าสูงกว่าอำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสต์และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอำนาจการทดสอบของวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าสูงกว่าอำนาจการทดสอบของวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สำหรับอำนาจการทดสอบระหว่างวิธีการตรวจสอบคู่อื่น ๆ ที่เหลือมีค่าไม่แตกต่างกัน

กรณีที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบระหว่างวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้ลักษณะของข้อสอบต่างกัน 9 ลักษณะ โดยใช้วิธีการทดสอบเป็นรายคู่ของ Tukey พบว่า อำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสต์ปรับใหม่ภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_L, b_M$  มีค่าสูงสุด โดยมีค่าสูงกว่าอำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสต์และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลในทุกเงื่อนไขของการตรวจสอบ ส่วนอำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสต์ภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_H, b_L$  มีค่าต่ำสุด โดยมีค่าต่ำกว่าอำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสต์ปรับใหม่และวิธีการถดถอยโลจิสติกเกือบทุกเงื่อนไขของการตรวจสอบ

1.2 การตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนุกรมภายใต้ความยาวของแบบสอบต่างกัน 2 ระดับ พบว่า อำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสต์ปรับใหม่ภายใต้ความยาวของแบบสอบ 30 ข้อ และ 60 ข้อ มีค่าประมาณร้อยละ 28.17 และ 29.12 ตามลำดับ สำหรับวิธีชิปเทสต์ พบว่า อำนาจการทดสอบภายใต้ความยาวของแบบสอบ 30 ข้อ และ 60 ข้อ มีค่าประมาณร้อยละ 13.05 และ 13.61 ตามลำดับ สำหรับวิธีแมนเทล-แฮนส์เซล พบว่า อำนาจการทดสอบภายใต้ความยาวของแบบสอบ 30 ข้อ และ 60 ข้อ มีค่าประมาณร้อยละ 16.77 และ 16.12 ตามลำดับ สำหรับวิธีการถดถอยโลจิสติก พบว่า อำนาจการทดสอบภายใต้ความยาวของแบบสอบ 30 ข้อ และ 60 ข้อ มีค่าประมาณร้อยละ 31.38 และ 28.82 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบระหว่างวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีดังกล่าวภายใต้ความยาวของแบบสอบต่างกัน 2 ระดับ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 2 ทาง ปรากฏว่า ผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการตรวจสอบและความยาวของแบบสอบไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงว่า วิธีการตรวจสอบและความยาวของแบบสอบไม่มีผลร่วมกันต่ออำนาจการทดสอบ เมื่อพิจารณาผลของความยาวของแบบสอบ พบว่า ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงว่า ความยาวของแบบสอบไม่มีผลต่ออำนาจการทดสอบ และเมื่อพิจารณาผลของวิธีการตรวจสอบ พบว่า มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า วิธีการตรวจสอบมีผลต่ออำนาจการทดสอบ ดังนั้นจึงเปรียบเทียบเพียงกรณีเดียว คือ เปรียบเทียบอำนาจการทดสอบระหว่างวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้ความยาวของแบบสอบระดับเดียวกัน 2 ระดับ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลปรากฏดังนี้

เมื่อเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนุกรมระหว่างวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้ความยาวของแบบสอบระดับเดียวกัน 2 ระดับ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่า มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นจึงนำอำนาจการทดสอบระหว่างวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้ความยาวของแบบสอบ 30 ข้อ และ 60 ข้อ มาเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ปรากฏว่า อำนาจการทดสอบภายใต้ความยาวของแบบสอบ 30 ข้อ และ 60 ข้อ ได้ผลสอดคล้องกัน กล่าวคือ อำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสต์ปรับใหม่และวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าไม่แตกต่างกัน และทั้ง 2 วิธีดังกล่าวมีอำนาจการทดสอบสูงกว่าวิธีชิปเทสต์และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสต์และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลมีค่าไม่แตกต่างกัน

1.3 การตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนุกรมภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันมีจำนวนต่างกัน 3 ระดับ พบว่า อำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสต์ปรับใหม่ภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน 10% มีค่าสูงสุด (ประมาณร้อยละ 30.08)

รองลงมาได้แก่ภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน 20% และ 5% ตามลำดับ (ประมาณร้อยละ 28.56 และ 27.29 ตามลำดับ) ส่วนวิธีชิปเทสต์ พบว่า อำนาจการทดสอบภายใต้สัดส่วนของข้อสอบ ที่ทำหน้าที่ต่างกัน 5% มีค่าสูงสุด (ประมาณร้อยละ 14.94) รองลงมาได้แก่ภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน 10% และ 20% ตามลำดับ (ประมาณร้อยละ 14.19 และ 10.85 ตามลำดับ) สำหรับวิธีแมนเทล-แฮนส์เซล พบว่า อำนาจการทดสอบภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน 5% มีค่าสูงสุด (ประมาณร้อยละ 20.94) รองลงมาได้แก่ภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน 10% และ 20% ตามลำดับ (ประมาณร้อยละ 17.13 และ 11.28 ตามลำดับ) ส่วนวิธีการถดถอยโลจิสติก พบว่า อำนาจการทดสอบภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน 5% มีค่าสูงสุด (ประมาณร้อยละ 38.24) รองลงมาได้แก่ภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน 10% และ 20% ตามลำดับ (ประมาณร้อยละ 31.00 และ 21.06 ตามลำดับ) เมื่อเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบระหว่างวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันมีจำนวนต่างกัน 3 ระดับ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 2 ทาง พบว่า ผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการตรวจสอบและสัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นจึงเปรียบเทียบ 3 กรณี คือ (1) เปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของแต่ละวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันมีจำนวนต่างกัน 3 ระดับ (2) เปรียบเทียบอำนาจการทดสอบระหว่างวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันระดับเดียวกัน 3 ระดับ และ (3) เปรียบเทียบอำนาจการทดสอบระหว่างวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันมีจำนวนต่างกัน 3 ระดับ ผลปรากฏดังนี้

กรณีที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของแต่ละวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันมีจำนวนต่างกัน 3 ระดับ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่า อำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสต์ปรับใหม่และวิธีชิปเทสต์มีค่าไม่แตกต่างกัน แสดงว่า ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบบอเนกรูป สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันไม่มีผลต่ออำนาจการทดสอบของ 2 วิธีดังกล่าว ส่วนอำนาจการทดสอบของวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลและวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบบอเนกรูป สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันมีผลต่ออำนาจการทดสอบของทั้ง 2 วิธีดังกล่าว ดังนั้นจึงนำอำนาจการทดสอบของวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลและวิธีการถดถอยโลจิสติก ภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันมีจำนวนต่างกัน 3 ระดับมาเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการทดสอบของ Tukey ผลปรากฏว่า

อำนาจการทดสอบของวิธีแมนเทิล-แฮนส์เซลภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน 5% มีค่าสูงกว่าอำนาจการทดสอบภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน 20% อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอำนาจการทดสอบภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันคู่อื่น ๆ ที่เหลือมีค่าไม่แตกต่างกัน

อำนาจการทดสอบของวิธีการถดถอยโลจิสติกภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน 20% มีค่าต่ำกว่าอำนาจการทดสอบภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน 5% และ 10% อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอำนาจการทดสอบภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน 5% และ 10% มีค่าไม่แตกต่างกัน

**กรณีที่ 2** เมื่อเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนุกรมระหว่างวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันระดับเดียวกัน 3 ระดับโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ปรากฏว่า มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นจึงนำอำนาจการทดสอบระหว่างวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน 5%, 10% และ 20% มาเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการทดสอบของ Tukey ผลปรากฏว่า อำนาจการทดสอบภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน 5%, 10% และ 20% ได้ผลสอดคล้องกัน กล่าวคือ อำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสต์ปรับใหม่และวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าไม่แตกต่างกัน แต่ทั้ง 2 วิธีดังกล่าวมีอำนาจการทดสอบสูงกว่าวิธีชิปเทสต์และวิธีแมนเทิล-แฮนส์เซลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสต์และวิธีแมนเทิล-แฮนส์เซลมีค่าไม่แตกต่างกัน

**กรณีที่ 3** เมื่อเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบระหว่างวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันมีจำนวนต่างกัน 3 ระดับ โดยใช้วิธีการทดสอบเป็นรายคู่ของ Tukey ผลปรากฏว่า อำนาจการทดสอบของวิธีการถดถอยโลจิสติกภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน 5% มีค่าสูงสุด โดยมีค่าสูงกว่าอำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสต์และวิธีแมนเทิล-แฮนส์เซลในทุกเงื่อนไขของการตรวจสอบ ในขณะที่เดียวกัน อำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสต์ภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน 20% มีค่าต่ำสุด โดยมีค่าต่ำกว่าอำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสต์ปรับใหม่และวิธีการถดถอยโลจิสติกเกือบทุกเงื่อนไขของการตรวจสอบ

1.4 การตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนุกรมภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่างต่างกัน 6 ระดับ ปรากฏว่า อำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสต์ปรับใหม่ภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  $N_R : N_F = 1000 : 1000$  มีค่าสูงสุด (ประมาณร้อยละ 42.13) รองลงมาได้แก่ภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  $N_R : N_F = 1000 : 500, 500 : 500, 1000 : 250, 500 : 250$  และ  $250 : 250$

ตามลำดับ (ประมาณร้อยละ 33.94, 30.41, 24.28, 21.09 และ 20.00 ตามลำดับ) สำหรับวิธีซีปเทสท์ พบว่า อำนาจการทดสอบภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  $N_R : N_F = 1000 : 1000$  มีค่าสูงสุด (ประมาณร้อยละ 21.28) รองลงมาได้แก่ภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  $N_R : N_F = 1000 : 500$ ,  $1000 : 250$ ,  $500 : 500$ ,  $500 : 250$  และ  $250 : 250$  ตามลำดับ (ประมาณร้อยละ 14.17, 12.65, 12.63, 10.17 และ 9.09 ตามลำดับ) สำหรับวิธีแมนเทิล-แฮนส์เซล ปรากฏว่า อำนาจการทดสอบภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  $N_R : N_F = 1000 : 1000$  มีค่าสูงสุด (ประมาณร้อยละ 26.13) รองลงมาได้แก่ภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  $N_R : N_F = 1000 : 500$ ,  $1000 : 250$ ,  $500 : 500$ ,  $500 : 250$  และ  $250 : 250$  ตามลำดับ (ประมาณร้อยละ 22.54, 13.41, 13.09, 12.72 และ 10.80 ตามลำดับ) สำหรับวิธีการถดถอยโลจิสติก พบว่า อำนาจการทดสอบภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  $N_R : N_F = 1000 : 1000$  มีค่าสูงสุด (ประมาณร้อยละ 46.76) รองลงมาได้แก่ภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  $N_R : N_F = 1000 : 500$ ,  $500 : 500$ ,  $250 : 250$ ,  $1000 : 250$  และ  $500 : 250$  ตามลำดับ (ประมาณร้อยละ 34.54, 27.93, 24.38, 24.37 และ 22.63 ตามลำดับ) เมื่อเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบระหว่างวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่างต่างกัน 6 ระดับ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 2 ทาง ปรากฏว่า ผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการตรวจสอบและขนาดกลุ่มตัวอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงว่า วิธีการตรวจสอบและขนาดกลุ่มตัวอย่างไม่มีผลร่วมกันต่ออำนาจการทดสอบ เมื่อพิจารณาผลของขนาดกลุ่มตัวอย่าง ปรากฏว่า มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า ขนาดกลุ่มตัวอย่างมีผลต่ออำนาจการทดสอบ และเมื่อพิจารณาผลของวิธีการตรวจสอบ ปรากฏว่า มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า วิธีการตรวจสอบมีผลต่ออำนาจการทดสอบ ดังนั้นจึงเปรียบเทียบ 2 กรณี คือ (1) เปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของแต่ละวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่างต่างกัน 6 ระดับ และ (2) เปรียบเทียบอำนาจการทดสอบระหว่างวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่างระดับเดียวกัน 6 ระดับ ผลปรากฏดังนี้

กรณีที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของแต่ละวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่างต่างกัน 6 ระดับ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่ามีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนเนกรูป ขนาดกลุ่มตัวอย่างมีผลต่ออำนาจการทดสอบของวิธีการตรวจสอบทั้ง 4 วิธี ดังนั้นจึงนำอำนาจการทดสอบของแต่ละวิธีการตรวจสอบทั้ง 4 วิธีภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่างต่างกัน 6 ระดับ มาเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการทดสอบของ Tukey ผลปรากฏว่า

อำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสต์ปรับปรุงใหม่ภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  $N_R : N_F = 1000 : 1000$  มีค่าสูงกว่าอำนาจการทดสอบภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  $N_R : N_F = 250 : 250$ ,  $500 : 250$  และ  $1000 : 250$  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอำนาจการทดสอบภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่างคู่อื่น ๆ ที่เหลือมีค่าไม่แตกต่างกัน

อำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสต์ภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  $N_R : N_F = 1000 : 1000$  มีค่าสูงกว่าอำนาจการทดสอบภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  $N_R : N_F = 250 : 250$  และ  $500 : 250$  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอำนาจการทดสอบภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่างคู่อื่น ๆ ที่เหลือมีค่าไม่แตกต่างกัน

อำนาจการทดสอบของวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  $N_R : N_F = 1000 : 1000$  มีค่าสูงกว่าอำนาจการทดสอบภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  $N_R : N_F = 250 : 250$ ,  $500 : 250$ ,  $500 : 500$  และ  $1000 : 250$  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอำนาจการทดสอบภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่างคู่อื่น ๆ ที่เหลือมีค่าไม่แตกต่างกัน

อำนาจการทดสอบของวิธีการถดถอยโลจิสติกภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  $N_R : N_F = 1000 : 1000$  มีค่าสูงกว่าอำนาจการทดสอบภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  $N_R : N_F = 250 : 250$ ,  $500 : 250$ ,  $500 : 500$  และ  $1000 : 250$  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอำนาจการทดสอบภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่างคู่อื่น ๆ ที่เหลือมีค่าไม่แตกต่างกัน

กรณีที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบบอเนกรูประหว่างวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่างระดับเดียวกัน 6 ระดับ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ปรากฏว่า มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นจึงนำอำนาจการทดสอบระหว่างวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้ง 6 ระดับ มาเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการทดสอบของ Tukey ผลปรากฏว่า

ภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  $N_R : N_F = 250 : 250$ ,  $500 : 500$ ,  $1000 : 250$  และ  $1000 : 1000$  ได้ผลการตรวจสอบสอดคล้องกัน กล่าวคือ อำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสต์ปรับปรุงใหม่และวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าไม่แตกต่างกัน แต่ทั้ง 2 วิธีดังกล่าวมีอำนาจการทดสอบสูงกว่าวิธีชิปเทสต์และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนวิธีชิปเทสต์และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลมีอำนาจการทดสอบไม่แตกต่างกัน

ภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  $N_R : N_F = 500 : 250$  อำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสต์-ปรับใหม่มีค่าสูงกว่าอำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสต์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนวิธีการถดถอยโลจิสติกมีอำนาจการทดสอบสูงกว่าวิธีชิปเทสต์และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอำนาจการทดสอบระหว่างวิธีการตรวจสอบคู่อื่น ๆ ที่เหลือมีค่าไม่แตกต่างกัน

ภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  $N_R : N_F = 1000 : 500$  อำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสต์-ปรับใหม่และวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าสูงกว่าอำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสต์ วิธีแมนเทล-แฮนส์เซลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอำนาจการทดสอบระหว่างวิธีการตรวจสอบคู่อื่น ๆ ที่เหลือมีค่าไม่แตกต่างกัน

2. การเปรียบเทียบอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบบอเนกรูประหว่างวิธีชิปเทสต์ปรับใหม่ วิธีชิปเทสต์ วิธีแมนเทล-แฮนส์เซล และวิธีการถดถอยโลจิสติก ภายใต้เงื่อนไขของปัจจัยที่ศึกษา ปรากฏผลดังนี้

2.1 การตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบบอเนกรูปภายใต้ลักษณะของข้อสอบต่างกัน 9 ลักษณะ พบว่า อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสต์ปรับใหม่ ภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_L, b_H$  มีค่าสูงสุด (ประมาณร้อยละ 10.78) รองลงมาได้แก่ภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_L, b_M; a_L, b_L; a_M, b_L; a_M, b_H; a_H, b_H; a_H, b_L; a_H, b_M$  และ  $a_M, b_M$  ตามลำดับ (ประมาณร้อยละ 10.64, 9.50, 9.28, 8.64, 8.25, 7.92, 7.56 และ 7.36 ตามลำดับ) สำหรับวิธีชิปเทสต์ พบว่า อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_M, b_H$  มีค่าสูงสุด (ประมาณร้อยละ 5.64) รองลงมาได้แก่ภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_L, b_M; a_H, b_H; a_M, b_L; a_L, b_H; a_M, b_M; a_H, b_L; a_H, b_M$  และ  $a_L, b_L$  ตามลำดับ (ประมาณร้อยละ 5.00, 4.89, 4.39, 4.28, 4.17, 3.89, 3.58 และ 2.94 ตามลำดับ) สำหรับวิธีแมนเทล-แฮนส์เซล พบว่า อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_L, b_H$  มีค่าสูงสุด (ประมาณร้อยละ 7.39) รองลงมาได้แก่ภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_L, b_M; a_H, b_H; a_M, b_H; a_M, b_L; a_L, b_L; a_H, b_M; a_M, b_M$  และ  $a_H, b_L$  ตามลำดับ (ประมาณร้อยละ 6.31, 5.64, 5.56, 4.92, 4.53, 3.75, 3.69 และ 2.31 ตามลำดับ) ส่วนวิธีการถดถอยโลจิสติก พบว่า อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_L, b_L$  มีค่าสูงสุด (ประมาณร้อยละ 9.94) รองลงมาได้แก่ภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_L, b_H; a_L, b_M; a_M, b_H; a_M, b_L; a_H, b_H; a_H, b_L; a_M, b_M$  และ  $a_H, b_M$

ตามลำดับ (ประมาณร้อยละ 9.33, 9.25, 8.17, 8.06, 7.92, 6.36, 6.19 และ 5.36 ตามลำดับ) เมื่อเปรียบเทียบอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ระหว่างวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีดังกล่าวภายใต้ลักษณะของข้อสอบต่างกัน 9 ลักษณะ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 2 ทาง พบว่าผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการตรวจสอบและลักษณะของข้อสอบมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นจึงเปรียบเทียบ 3 กรณี คือ (1) เปรียบเทียบอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของแต่ละวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้ลักษณะของข้อสอบต่างกัน 9 ลักษณะ (2) เปรียบเทียบอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ระหว่างวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้ลักษณะของข้อสอบเดียวกัน 9 ลักษณะ และ (3) เปรียบเทียบอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ระหว่างวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้ลักษณะของข้อสอบต่างกัน 9 ลักษณะ ผลปรากฏดังนี้

กรณีที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของแต่ละวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้ลักษณะของข้อสอบต่างกัน 9 ลักษณะ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่า มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนุกรม ลักษณะของข้อสอบมีผลต่ออัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีการตรวจสอบทั้ง 4 วิธี ดังนั้นจึงนำอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของแต่ละวิธีการตรวจสอบทั้ง 4 วิธีภายใต้ลักษณะของข้อสอบต่างกัน 9 ลักษณะมาเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการทดสอบของ Tukey ผลปรากฏว่า วิธีชิปเทสท์ปรับใหม่ไม่พบความแตกต่าง ส่วนวิธีชิปเทสท์ วิธีแมนเทล-แฮนส์เชล และวิธีการถดถอยโลจิสติกได้ผลดังนี้

อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสท์ภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_M, b_H$  มีค่าสูงกว่าอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_L, b_L$  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ภายใต้ลักษณะของข้อสอบคู่อื่น ๆ ที่เหลือมีค่าไม่แตกต่างกัน

อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีแมนเทล-แฮนส์เชลภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_L, b_H$  มีค่าสูงกว่าอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_L, b_L; a_M, b_M; a_H, b_L$  และ  $a_H, b_M$  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สำหรับอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_L, b_M; a_M, b_H$  และ  $a_H, b_H$  มีค่าสูงกว่าอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_H, b_L$  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ภายใต้ลักษณะของข้อสอบคู่อื่น ๆ ที่เหลือมีค่าไม่แตกต่างกัน



อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีการถดถอยโลจิสติกภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_L, b_L$  มีค่าสูงกว่าอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_M, b_M; a_H, b_L$  และ  $a_H, b_M$  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_L, b_H$  มีค่าสูงกว่าอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_M, b_M$  และ  $a_H, b_M$  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สำหรับอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_L, b_M$  มีค่าสูงกว่าอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_H, b_M$  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ภายใต้ลักษณะของข้อสอบคู่อื่น ๆ ที่เหลือมีค่าไม่แตกต่างกัน

กรณีที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบระหว่างวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้ลักษณะของข้อสอบเดียวกัน 9 ลักษณะ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวพบว่า ภายใต้ลักษณะของข้อสอบทั้ง 9 ลักษณะ อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนเนกรูระหว่างวิธีชิปเทสท์ปรับใหม่ วิธีชิปเทสท์วิธีแมนเทิล-แฮนส์เซลและวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นจึงนำอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ระหว่างวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้ลักษณะของข้อสอบ 9 ลักษณะมาเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการทดสอบของ Tukey ผลปรากฏดังนี้

ภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_L, b_L; a_L, b_M; a_M, b_L$  และ  $a_H, b_L$  ได้ผลสอดคล้องกันกล่าวคือ อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสท์ปรับใหม่และวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าสูงกว่าอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสท์และวิธีแมนเทิล-แฮนส์เซลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ระหว่างวิธีการตรวจสอบคู่อื่น ๆ ที่เหลือมีค่าไม่แตกต่างกัน

ภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_L, b_H$  อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสท์ปรับใหม่มีค่าสูงกว่าอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีแมนเทิล-แฮนส์เซลและวิธีชิปเทสท์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนวิธีการถดถอยโลจิสติกและวิธีแมนเทิล-แฮนส์เซลมีอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 สูงกว่าวิธีชิปเทสท์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สำหรับอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ระหว่างวิธีการตรวจสอบคู่อื่น ๆ ที่เหลือมีค่าไม่แตกต่างกัน

ภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_M$ ,  $b_M$  อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสท์ปรับปรุงมีค่าสูงกว่าอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีแมนเทล-แฮนส์เซล และวิธีชิปเทสท์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สำหรับวิธีการถดถอยโลจิสติกมีอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 สูงกว่าวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ระหว่างวิธีการตรวจสอบคู่อื่น ๆ ที่เหลือมีค่าไม่แตกต่างกัน

ภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_M$ ,  $b_H$  และ  $a_H$ ,  $b_M$  ได้ผลสอดคล้องกัน กล่าวคืออัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสท์ปรับปรุงมีค่าสูงกว่าอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสท์และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ระหว่างวิธีการตรวจสอบคู่อื่น ๆ ที่เหลือมีค่าไม่แตกต่างกัน

ภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_H$ ,  $b_H$  อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสท์ปรับปรุงมีค่าสูงกว่าอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีแมนเทล-แฮนส์เซล และวิธีชิปเทสท์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สำหรับวิธีการถดถอยโลจิสติกมีอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 สูงกว่าวิธีชิปเทสท์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ระหว่างวิธีการตรวจสอบคู่อื่น ๆ ที่เหลือมีค่าไม่แตกต่างกัน

กรณีที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ระหว่างวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้ลักษณะของข้อสอบต่างกัน 9 ลักษณะ โดยใช้วิธีการทดสอบเป็นรายคู่ของ Tukey ผลปรากฏว่า อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสท์ปรับปรุงภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_L$ ,  $b_H$  มีค่าสูงสุด โดยมีค่าสูงกว่าอำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสท์และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลเกือบทุกเงื่อนไขของการตรวจสอบ ในขณะเดียวกัน อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_H$ ,  $b_L$  มีค่าต่ำสุด โดยมีค่าต่ำกว่าอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสท์ปรับปรุงและวิธีการถดถอยโลจิสติกเกือบทุกเงื่อนไขของการตรวจสอบ

2.2 การตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนุกรมภายใต้ความยาวของแบบสอบต่างกัน 2 ระดับ พบว่า อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสท์ปรับปรุงภายใต้ความยาวของแบบสอบ 30 ข้อ มีค่าประมาณร้อยละ 9.62 และอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ภายใต้ความยาวของแบบสอบ 60 ข้อ มีค่าประมาณร้อยละ 8.14 สำหรับวิธีชิปเทสท์ พบว่า อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ภายใต้ความยาวของแบบสอบ 30 ข้อ มีค่าประมาณร้อยละ 4.84 และอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ภายใต้ความยาวของแบบสอบ 60 ข้อ มีค่าประมาณร้อยละ 3.78 สำหรับวิธีแมนเทล-แฮนส์เซล พบว่า อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1

ภายใต้ความยาวของแบบสอบ 30 ข้อ มีค่าประมาณร้อยละ 5.07 และอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ภายใต้ความยาวของแบบสอบ 60 ข้อ มีค่าประมาณร้อยละ 4.73 สำหรับวิธีการถดถอยโลจิสติก พบว่า อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ภายใต้ความยาวของแบบสอบ 30 ข้อ มีค่าประมาณร้อยละ 8.04 และอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ภายใต้ความยาวของแบบสอบ 60 ข้อ มีค่าประมาณร้อยละ 7.64 เมื่อเปรียบเทียบอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ระหว่างวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีดังกล่าวภายใต้ความยาวของแบบสอบต่างกัน 2 ระดับโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 2 ทาง ปรากฏว่า ผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการตรวจสอบและความยาวของแบบสอบไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงว่า วิธีการตรวจสอบและความยาวของแบบสอบไม่มีผลร่วมกันต่ออัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 เมื่อพิจารณาผลของความยาวของแบบสอบ พบว่า มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า ความยาวของแบบสอบมีผลต่ออัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และเมื่อพิจารณาผลของวิธีการตรวจสอบ พบว่า มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า วิธีการตรวจสอบมีผลต่ออัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ดังนั้นจึงเปรียบเทียบ 2 กรณี คือ (1) เปรียบเทียบอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของแต่ละวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้ความยาวของแบบสอบต่างกัน 2 ระดับ และ (2) เปรียบเทียบอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ระหว่างวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้ความยาวของแบบสอบระดับเดียวกัน 2 ระดับ ผลปรากฏดังนี้

กรณีที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของแต่ละวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้ความยาวของแบบสอบต่างกัน 2 ระดับ โดยใช้สถิติ t-test กรณีกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน ผลปรากฏว่า อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีแมนเทิล-แฮนส์เชลและวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าไม่แตกต่างกัน แสดงว่า ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนุกรม ความยาวของแบบสอบไม่มีผลต่ออัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของ 2 วิธีดังกล่าว ส่วนอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสต์ปรับใหม่และวิธีชิปเทสต์ภายใต้ความยาวของแบบสอบ 30 ข้อ มีค่าสูงกว่าอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ภายใต้ความยาวของแบบสอบ 60 ข้อ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนุกรม ปัจจัยทางด้านความยาวของแบบสอบมีผลต่ออัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของ 2 วิธีดังกล่าว

กรณีที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนุกรมระหว่างวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้ความยาวของแบบสอบระดับเดียวกัน 2 ระดับโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่า มีค่า

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นจึงนำอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ระหว่างวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้ความยาวของแบบสอบ 30 ข้อ และ 60 ข้อ มาเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการทดสอบของ Tukey ผลปรากฏว่า

ภายใต้ความยาวของแบบสอบ 30 ข้อ อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสต์ปรับปรุงใหม่มีค่าสูงกว่าอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสต์ วิธีแมนเทล-แฮนส์เซล และวิธีการถดถอยโลจิสติกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าสูงกว่าอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสต์และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสต์และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลมีค่าไม่แตกต่างกัน

ภายใต้ความยาวของแบบสอบ 60 ข้อ อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสต์ปรับปรุงใหม่และวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าไม่แตกต่างกัน แต่ทั้ง 2 วิธีดังกล่าวมีอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 สูงกว่าวิธีชิปเทสต์และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสต์และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลมีค่าไม่แตกต่างกัน

2.3 การตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนุกรมภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันแบบสอบมีจำนวนต่างกัน 3 ระดับ พบว่า อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสต์ปรับปรุงใหม่ภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน 20% มีค่าสูงสุด (ประมาณร้อยละ 9.75) รองลงมาได้แก่ภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน 5% และ 10% ตามลำดับ (ประมาณร้อยละ 9.02 และ 7.87 ตามลำดับ) สำหรับวิธีชิปเทสต์ พบว่า อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน 10% มีค่าสูงสุด (ประมาณร้อยละ 4.64) รองลงมาได้แก่ภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน 5% และ 20% ตามลำดับ (ประมาณร้อยละ 4.35 และ 3.94 ตามลำดับ) ส่วนวิธีแมนเทล-แฮนส์เซล พบว่า อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน 10% มีค่าสูงสุด (ประมาณร้อยละ 5.19) รองลงมาได้แก่ภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน 5% และ 20% ตามลำดับ (ประมาณร้อยละ 5.06 และ 4.44 ตามลำดับ) สำหรับวิธีการถดถอยโลจิสติก พบว่า อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน 20% มีค่าสูงสุด (ประมาณร้อยละ 8.29) รองลงมาได้แก่ภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน 10% และ 5% ตามลำดับ (ประมาณร้อยละ 7.63 และ 7.61 ตามลำดับ) เมื่อเปรียบเทียบอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ระหว่างวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันมีจำนวน

ต่างกัน 3 ระดับ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 2 ทาง พบว่า ผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการตรวจสอบและสัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นจึงเปรียบเทียบ 3 กรณี คือ (1) เปรียบเทียบอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของแต่ละวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันมีจำนวนต่างกัน 3 ระดับ (2) เปรียบเทียบอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ระหว่างวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันระดับเดียวกัน 3 ระดับ และ (3) เปรียบเทียบอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ระหว่างวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันมีจำนวนต่างกัน 3 ระดับ ผลปรากฏดังนี้

**กรณีที่ 1** เมื่อเปรียบเทียบอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของแต่ละวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันมีจำนวนต่างกัน 3 ระดับ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ปรากฏว่า อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสท์ วิธีแมนเทิล-แอนส์เชล และวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าไม่แตกต่างกัน แสดงว่า ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนเนกรูป สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันไม่มีผลต่ออัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของ 3 วิธีดังกล่าว ส่วนอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสท์ปรับใหม่มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนเนกรูป สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันมีผลต่ออัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีดังกล่าว ดังนั้นจึงเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการทดสอบของ Tukey ผลปรากฏว่า อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน 20% มีค่าสูงกว่าอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน 10% อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันคู่อื่น ๆ ที่เหลือมีค่าไม่แตกต่างกัน

**กรณีที่ 2** เมื่อเปรียบเทียบอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนเนกรูประหว่างวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันระดับเดียวกัน 3 ระดับโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ปรากฏว่า มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นจึงนำอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ระหว่างวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน 5%, 10% และ 20% มาเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการทดสอบของ Tukey ผลปรากฏว่า ได้ผลสอดคล้องกัน กล่าวคือ อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสท์-

ปรับใหม่และวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าไม่แตกต่างกัน แต่ทั้ง 2 วิธีมีอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 สูงกว่าวิธีชิปเทสต์และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ระหว่างวิธีชิปเทสต์และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลมีค่าไม่แตกต่างกัน

**กรณีที่ 3** เมื่อเปรียบเทียบอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ระหว่างวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันมีจำนวนต่างกัน 3 ระดับ โดยใช้วิธีการทดสอบเป็นรายคู่ของ Tukey ผลปรากฏว่า อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสต์ปรับใหม่ภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน 20% มีค่าสูงสุด โดยมีค่าสูงกว่าอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสต์และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลในทุกเงื่อนไขของการตรวจสอบ ในขณะที่เดียวกัน อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสต์ภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน 20% มีค่าต่ำสุด โดยมีค่าต่ำกว่าอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสต์ปรับใหม่และวิธีการถดถอยโลจิสติกในทุกเงื่อนไขของการตรวจสอบ

2.4 การตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบบอเนกรูปภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่างต่างกัน 6 ระดับ ปรากฏว่า อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสต์ปรับใหม่ภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  $N_R : N_F = 1000 : 250$  มีค่าสูงสุด (ประมาณร้อยละ 10.04) รองลงมาได้แก่ภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  $N_R : N_F = 500 : 250, 500 : 500, 250 : 250, 1000 : 500$  และ  $1000 : 1000$  ตามลำดับ (ประมาณร้อยละ 10.00, 9.04, 8.69, 8.24 และ 7.28 ตามลำดับ) สำหรับวิธีชิปเทสต์ พบว่า อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  $N_R : N_F = 1000 : 250$  มีค่าสูงสุด (ประมาณร้อยละ 5.02) รองลงมาได้แก่ภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  $N_R : N_F = 250 : 250, 500 : 250, 500 : 500, 1000 : 500$  และ  $1000 : 1000$  ตามลำดับ (ประมาณร้อยละ 4.69, 4.61, 4.56, 3.59 และ 3.39 ตามลำดับ) สำหรับวิธีแมนเทล-แฮนส์เซล พบว่า อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  $N_R : N_F = 1000 : 500$  มีค่าสูงสุด (ประมาณร้อยละ 5.61) รองลงมาได้แก่ภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  $N_R : N_F = 250 : 250, 1000 : 250, 500 : 250, 500 : 500$  และ  $1000 : 1000$  (ประมาณร้อยละ 5.52, 4.74, 4.69, 4.67 และ 4.17 ตามลำดับ) สำหรับวิธีการถดถอยโลจิสติก พบว่า อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  $N_R : N_F = 250 : 250$  มีค่าสูงสุด (ประมาณร้อยละ 9.28) รองลงมาได้แก่ภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  $N_R : N_F = 500 : 500, 500 : 250, 1000 : 250, 1000 : 500$  และ  $1000 : 1000$  (ประมาณร้อยละ 8.63, 8.09, 7.94, 6.93 และ 6.19 ตามลำดับ) เมื่อเปรียบเทียบอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ระหว่างวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง

ต่างกัน 6 ระดับ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 2 ทาง ปรากฏว่า ผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการตรวจสอบและขนาดกลุ่มตัวอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงว่า วิธีการตรวจสอบและขนาดกลุ่มตัวอย่างไม่มีผลร่วมกันต่ออัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 เมื่อพิจารณาผลของขนาดกลุ่มตัวอย่าง ปรากฏว่า มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า ขนาดกลุ่มตัวอย่างมีผลต่ออัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และเมื่อพิจารณาผลของวิธีการตรวจสอบ ปรากฏว่า มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า วิธีการตรวจสอบมีผลต่ออัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ดังนั้นจึงเปรียบเทียบ 2 กรณี คือ (1) เปรียบเทียบอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของแต่ละวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่างต่างกัน 6 ระดับ และ (2) เปรียบเทียบอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ระหว่างวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่างระดับเดียวกัน 6 ระดับ ผลปรากฏดังนี้

กรณีที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของแต่ละวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่างต่างกัน 6 ระดับ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลปรากฏว่า วิธีซีปเทสท์ปรับใหม่ วิธีซีปเทสท์ และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลมีค่าไม่แตกต่างกัน แสดงว่า ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนุกรม ขนาดกลุ่มตัวอย่างไม่มีผลต่ออัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีการตรวจสอบทั้ง 3 วิธี ส่วนวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนุกรม ปัจจัยทางด้านขนาดกลุ่มตัวอย่างมีผลต่ออัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีดังกล่าว ดังนั้นจึงเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการทดสอบของ Tukey ปรากฏว่า อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีการถดถอยโลจิสติกภายใต้ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  $N_R : N_F = 1000 : 1000$  มีค่าต่ำกว่าอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  $N_R : N_F = 250 : 250$  และ  $500 : 500$  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่างคู่อื่น ๆ ที่เหลือมีค่าไม่แตกต่างกัน

กรณีที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนุกรมระหว่างวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่างระดับเดียวกัน 6 ระดับ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่า มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นจึงนำอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ระหว่างวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้ง 6 ระดับมาเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการทดสอบของ Tukey ผลปรากฏว่า

ภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  $N_R : N_F = 500 : 500, 500 : 250, 1000 : 250$  และ  $1000 : 1000$  ได้ผลสอดคล้องกัน กล่าวคือ อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีซิปเทสท์-ปรับใหม่และวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าไม่แตกต่างกัน และทั้ง 2 วิธีมีอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 สูงกว่าวิธีซิปเทสท์และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สำหรับอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีซิปเทสท์และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลมีค่าไม่แตกต่างกัน

ภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  $N_R : N_F = 1000 : 500$  อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีซิปเทสท์ปรับใหม่มีค่าสูงกว่าอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีซิปเทสท์และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สำหรับวิธีซิปเทสท์มีอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ต่ำกว่าวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลและวิธีการถดถอยโลจิสติกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ระหว่างวิธีการตรวจสอบคู่อื่น ๆ ที่เหลือมีค่าไม่แตกต่างกัน

2.5 การเปรียบเทียบอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีกับเกณฑ์ของอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ที่ระดับ 10% ภายใต้เงื่อนไขของปัจจัยที่ศึกษาปรากฏผลดังนี้

ภายใต้เงื่อนไขของลักษณะของข้อสอบ (TI) อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีซิปเทสท์ปรับใหม่มีค่าอยู่ในช่วงประมาณ 7.36% ถึง 10.78% ส่วนอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีซิปเทสท์มีค่าอยู่ในช่วงประมาณ 2.94% ถึง 5.64% สำหรับอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลมีค่าอยู่ในช่วงประมาณ 2.31% ถึง 7.39% ในขณะที่อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าอยู่ในช่วงประมาณ 5.36% ถึง 9.94% เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ที่ระดับ 10% ปรากฏว่า อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีซิปเทสท์ปรับใหม่มีค่าอยู่ในเกณฑ์เกือบทุกเงื่อนไขของลักษณะของข้อสอบ ส่วนอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของอีก 3 วิธีมีค่าอยู่ในเกณฑ์ทุกเงื่อนไขของลักษณะของข้อสอบ

ภายใต้เงื่อนไขของความยาวของแบบสอบ (TL) อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีซิปเทสท์ปรับใหม่มีค่าอยู่ในช่วงประมาณ 8.14% ถึง 9.62% ส่วนอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีซิปเทสท์มีค่าอยู่ในช่วงประมาณ 3.78% ถึง 4.84% สำหรับอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลมีค่าอยู่ในช่วงประมาณ 4.73% ถึง 5.07% ในขณะที่อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าอยู่ในช่วงประมาณ



7.64% ถึง 8.04% เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ที่ระดับ 10% ปรากฏว่า อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของทั้ง 4 วิธีมีค่าอยู่ภายในเกณฑ์ทุกเงื่อนไขของความยาวของแบบสอบ

ภายใต้เงื่อนไขของสัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน (%DIF) ในแบบสอบ อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสท์ปรับใหม่มีค่าอยู่ในช่วงประมาณ 7.87% ถึง 9.75% ส่วนอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสท์มีค่าอยู่ในช่วงประมาณ 3.94% ถึง 4.64% สำหรับอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลมีค่าอยู่ในช่วงประมาณ 4.44% ถึง 5.19% ส่วนอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าอยู่ในช่วงประมาณ 7.61% ถึง 8.29% เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ที่ระดับ 10% ปรากฏว่า อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของทั้ง 4 วิธีมีค่าอยู่ภายในเกณฑ์ทุกเงื่อนไขของสัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน

ภายใต้เงื่อนไขของขนาดกลุ่มตัวอย่าง ( $N_R : N_F$ ) อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสท์ปรับใหม่มีค่าอยู่ในช่วงประมาณ 7.28% ถึง 10.04% ส่วนอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสท์มีค่าอยู่ในช่วงประมาณ 3.39% ถึง 5.02% สำหรับอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลมีค่าอยู่ในช่วงประมาณ 4.17% ถึง 5.61% ในขณะที่อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าอยู่ในช่วงประมาณ 6.19% ถึง 9.28% เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ที่ระดับ 10% ปรากฏว่า อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสท์ปรับใหม่มีค่าอยู่ภายในเกณฑ์เกือบทุกเงื่อนไขของขนาดกลุ่มตัวอย่าง ส่วนอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของอีก 3 วิธีมีค่าอยู่ภายในเกณฑ์ทุกเงื่อนไขของขนาดกลุ่มตัวอย่าง

จากผลดังกล่าว เมื่อพิจารณาในทุกเงื่อนไขของปัจจัยที่ศึกษา ปรากฏว่า ค่าเฉลี่ยของอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีการตรวจสอบทั้ง 4 วิธีมีค่าอยู่ภายในเกณฑ์ที่ระดับ 10% โดยค่าเฉลี่ยของอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสท์ปรับใหม่ วิธีชิปเทสท์วิธีแมนเทล-แฮนส์เซล และวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าประมาณ 8.88, 4.31, 4.90 และ 7.84 ตามลำดับ

## อภิปรายผลการวิจัย

1. การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนเนกรูประหว่างวิธีชิปเทสท์ปรับใหม่ วิธีชิปเทสท์ วิธีแมนเทล-แฮนส์เซล และวิธีการถดถอยโลจิสติก ภายใต้เงื่อนไขของปัจจัยที่ศึกษา ปรากฏผลดังนี้

1.1 การตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนเนกรูปภายใต้ลักษณะของข้อสอบต่างกัน 9 ลักษณะ พบว่า ลักษณะของข้อสอบมีผลต่ออำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสท์ปรับใหม่ วิธีชิปเทสท์ วิธีแมนเทล-แฮนส์เซล และวิธีการถดถอยโลจิสติก กล่าวคือ เมื่อลักษณะของข้อสอบ  $a_L, b_M$  จะมีผลทำให้อำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสท์ปรับใหม่มีค่าสูงสุด เมื่อลักษณะของข้อสอบ  $a_M, b_M$  จะมีผลทำให้อำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสท์และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลมีค่าสูงสุด เมื่อลักษณะของข้อสอบ  $a_H, b_M$  จะมีผลทำให้อำนาจการทดสอบของวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าสูงสุด ทั้งนี้ข้อสังเกตว่า อำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสท์ปรับใหม่ วิธีแมนเทล-แฮนส์เซลและวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าเพิ่มขึ้นในทุกเงื่อนไขของลักษณะของข้อสอบที่มีค่าความยากปานกลาง ( $a_L, b_M; a_M, b_M$  และ  $a_H, b_M$ ) แต่อำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสท์มีค่าเพิ่มขึ้นเพียงบางเงื่อนไขของลักษณะของข้อสอบที่มีค่าความยากปานกลาง ( $a_M, b_M$ ) สาเหตุดังกล่าวอาจเนื่องมาจากข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันแบบอนเนกรูปมี 2 ลักษณะ คือ ข้อสอบทำหน้าที่ต่างกันแบบมีทิศทางเดียว (unidirectional DIF) และข้อสอบทำหน้าที่ต่างกันแบบไม่มีทิศทาง (nondirectional DIF) (Li and Stout, 1993 cited in Narayanan and Swaminathan, 1996) ข้อสอบทำหน้าที่ต่างกันแบบมีทิศทางเดียวเกิดขึ้นเมื่อมีปฏิสัมพันธ์เป็นลำดับ(ordinal interaction) ระหว่างการเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้สอบและระดับความสามารถ ซึ่งในทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (item response theory; IRT) สามารถพิจารณาได้จากโค้งลักษณะข้อสอบ (item characteristic curves; ICCs) ระหว่างกลุ่มผู้สอบ 2 กลุ่มตัดกันตรงปลายสุดของช่วงความสามารถต่ำหรือสูง ข้อสอบลักษณะดังกล่าวจะมีค่าความยากต่ำหรือสูงซึ่งไม่มีปัญหาเมื่อตรวจสอบด้วยวิธีชิปเทสท์ ส่วนข้อสอบทำหน้าที่ต่างกันแบบไม่มีทิศทางเกิดขึ้นเมื่อมีปฏิสัมพันธ์ไม่เป็นลำดับ (disordinal interaction) ระหว่างการเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้สอบและระดับความสามารถ ซึ่งทำให้โค้งลักษณะข้อสอบระหว่างกลุ่มผู้สอบ 2 กลุ่มตัดกันตรงจุดกึ่งกลางของช่วงความสามารถ ข้อสอบที่มีลักษณะนี้จะมีค่าความยากปานกลางซึ่งไม่สามารถตรวจสอบด้วยวิธีชิปเทสท์ ทั้งนี้เพราะว่าวิธีชิปเทสท์ใช้สถิติชนิดคิดเครื่องหมายคำนวณดัชนีข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน เมื่อขนาดของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันเปลี่ยนทิศทางตรงจุดกึ่งกลางของช่วงความสามารถจะทำให้ความแตกต่างที่มีเครื่องหมาย

ลขของช่วงคะแนนส่วนหนึ่งหักล้างกับความแตกต่างที่มีเครื่องหมายบวกของช่วงคะแนนอีกส่วนหนึ่ง ข้อสอบที่มีลักษณะดังกล่าวจึงไม่สามารถตรวจสอบด้วยวิธีชิปเทสท์ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงนำวิธีชิปเทสท์ของ Shealy และ Stout (1993) มาปรับปรุงขั้นตอนการวิเคราะห์โดยแบ่งกลุ่มผู้สอบออกเป็น 2 กลุ่มตามระดับคะแนนรวม คือ กลุ่มที่มีคะแนนสูงกับกลุ่มที่มีคะแนนต่ำ แล้ววิเคราะห์แยกกันในแต่ละกลุ่ม ผลการแบ่งกลุ่มผู้สอบจะทำให้โค้งลักษณะข้อสอบที่ตัดกันตรงจุดกึ่งกลางของช่วงความสามารถเปลี่ยนเป็นตัดกันตรงปลายสุดของช่วงความสามารถต่ำหรือสูง ดังนั้นจึงไม่มีผลต่อสถิติชนิดคิดเครื่องหมายของวิธีชิปเทสท์ปรับใหม่ นั่นคือ วิธีชิปเทสท์ปรับใหม่สามารถตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอเนกรูปที่ไม่มีทิศทางได้ ส่วนวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลก็สามารถอธิบายได้ในทำนองเดียวกัน ทั้งนี้เพราะว่าผู้วิจัยใช้วิธีแมนเทล-แฮนส์เซลแบบปรับปรุงขั้นตอนการวิเคราะห์ของ Mazor และคณะ (1994) ซึ่งใช้วิธีแบ่งกลุ่มผู้สอบ ดังนั้นจึงสามารถตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอเนกรูปในลักษณะของข้อสอบที่มีค่าความยากปานกลางได้ทุกเงื่อนไข สำหรับวิธีการถดถอยโลจิสติกจะไม่มีปัญหาในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอเนกรูป เนื่องจากเป็นวิธีที่ใช้โมเดลการถดถอยโลจิสติกวิเคราะห์ดัชนีการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ โมเดลดังกล่าวสามารถคำนวณปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเป็นสมาชิกของกลุ่มและระดับความสามารถ ดังนั้นจึงทำให้สามารถตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอเนกรูปที่มีทิศทางเดียวและไม่มีทิศทางได้ (Swaminathan and Rogers, 1990) ผลการศึกษาในครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Rogers และ Swaminathan (1993) ที่พบว่า ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันแบบอเนกรูป อำนาจการทดสอบของวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อลักษณะของข้อสอบมีค่าความยากสูงขึ้นหรือต่ำลง ทั้งยังไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Narayanan และ Swaminathan (1996) ที่พบว่า ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันแบบอเนกรูป อำนาจการทดสอบของวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อลักษณะของข้อสอบมีค่าอำนาจจำแนกสูงขึ้น

เมื่อเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอเนกรูประหว่างวิธีชิปเทสท์ปรับใหม่ วิธีชิปเทสท์ วิธีแมนเทล-แฮนส์เซล และวิธีการถดถอยโลจิสติก ภายใต้ลักษณะของข้อสอบ 9 ลักษณะ พบว่า ภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_L$ ,  $b_L$  และ  $a_L$ ,  $b_H$  อำนาจการทดสอบระหว่างวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีดังกล่าวมีค่าไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษาดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่กำหนดไว้ในข้อ 1 แสดงว่า เมื่อลักษณะของข้อสอบที่มีค่าอำนาจจำแนกต่ำและมีค่าความยากต่ำหรือสูง เมื่อใช้วิธีการตรวจสอบ 4 วิธีดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้ถูกต้องแม่นยำใกล้เคียงกัน ส่วนการตรวจสอบภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a_L$ ,  $b_M$ ;

$a_M, b_L; a_M, b_M; a_M, b_H; a_H, b_L; a_H, b_M$  และ  $a_H, b_H$  พบว่า ภายใต้เกือบทุกเงื่อนไขของการตรวจสอบ อำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสท์ปรับใหม่และวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าสูงใกล้เคียงกัน ส่วนอำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสท์และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลมีค่าต่ำใกล้เคียงกัน ทั้งวิธีชิปเทสท์ปรับใหม่และวิธีการถดถอยโลจิสติกมีอำนาจการทดสอบสูงกว่าวิธีชิปเทสท์และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซล โดยเฉพาะภายใต้ลักษณะของข้อสอบที่มีค่าอำนาจจำแนกต่ำกับความยากปานกลางจะมีผลทำให้อำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสท์ปรับใหม่มีค่าสูงสุด ในขณะที่ภายใต้ลักษณะของข้อสอบที่มีค่าอำนาจจำแนกสูงกับความยากต่ำจะมีผลทำให้อำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสท์มีค่าต่ำสุด ผลการศึกษาดังกล่าวเฉพาะวิธีชิปเทสท์ปรับใหม่ วิธีชิปเทสท์ และวิธีการถดถอยโลจิสติกสอดคล้องกับสมมติฐานที่กำหนดไว้ในข้อ 1 แสดงว่า วิธีชิปเทสท์ปรับใหม่ที่ผู้วิจัยนำมาปรับปรุงขั้นตอนการวิเคราะห์สามารถนำมาตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนุกรมได้เป็นอย่างดี มีความถูกต้องแม่นยำในการตรวจสอบสูงกว่าวิธีชิปเทสท์แบบเดิม ทั้งยังมีความถูกต้องแม่นยำในการตรวจสอบเทียบเท่ากับวิธีการถดถอยโลจิสติก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการปรับปรุงขั้นตอนการวิเคราะห์ของวิธีชิปเทสท์ซึ่งได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงมีผลทำให้สามารถตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนุกรมในลักษณะต่าง ๆ ได้ สำหรับวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ในข้อ 1 แสดงว่า วิธีแมนเทล-แฮนส์เซลแบบปรับปรุงขั้นตอนการวิเคราะห์ก็ถึงแม้ว่าจะมีอำนาจการทดสอบในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนุกรมสูงกว่าวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลแบบเดิม (Mazor and others, 1994) แต่เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับวิธีชิปเทสท์ปรับใหม่และวิธีการถดถอยโลจิสติก ปรากฏว่า มีอำนาจการทดสอบต่ำกว่าวิธีชิปเทสท์ปรับใหม่และวิธีการถดถอยโลจิสติก และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับวิธีชิปเทสท์ ปรากฏว่า มีอำนาจการทดสอบเท่าเทียมกัน ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Rogers และ Swaminathan (1993) Narayanan และ Swaminathan (1996) ที่พบว่า ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนุกรม วิธีการถดถอยโลจิสติกมีอำนาจการทดสอบสูงกว่าวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลภายใต้เกือบทุกเงื่อนไขของลักษณะของข้อสอบ แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของรัชนีทร์ มุคคา (2540) ที่พบว่า วิธีแมนเทล-แฮนส์เซลและวิธีการถดถอยโลจิสติกมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนุกรมเท่าเทียมกัน

1.2 การตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนุกรมภายใต้ความยาวของแบบสอบต่างกัน 2 ระดับ ปรากฏว่า ความยาวของแบบสอบไม่มีผลต่ออำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสท์ปรับใหม่ วิธีชิปเทสท์ วิธีแมนเทล-แฮนส์เซล และวิธีการถดถอยโลจิสติก แสดงว่า

ในการตรวจสอบด้วย 4 วิธีดังกล่าว ถ้าใช้ความยาวของแบบสอบ 30 ข้อ จะมีความถูกต้องแม่นยำใกล้เคียงกับการตรวจสอบโดยใช้ความยาวของแบบสอบ 60 ข้อ นั่นคือ ถึงแม้ว่าความยาวของแบบสอบจะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ความเที่ยงของคะแนนเพิ่มขึ้นด้วย แต่จะไม่มีผลต่ออำนาจการทดสอบของวิธีการตรวจสอบทั้ง 4 วิธี ผลการศึกษาดังกล่าวมีทั้งสอดคล้องและไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Swaminathan และ Rogers (1990) Rogers และ Swaminathan (1993) ที่พบว่า การตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันแบบอนุกรม ความยาวของแบบสอบไม่มีผลต่ออำนาจการทดสอบของวิธีแมนเทิล-แฮนส์เซล แต่จะมีผลต่อวิธีการถดถอยโลจิสติก กล่าวคือ เมื่อความยาวของแบบสอบเพิ่มขึ้นจะมีผลทำให้อำนาจการทดสอบของวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นในกรณีของวิธีแมนเทิล-แฮนส์เซลจะสอดคล้อง ส่วนในกรณีของวิธีการถดถอยโลจิสติกจะไม่สอดคล้อง นอกจากนี้ยังไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Ackerman และ Evans (1992 cited in Narayanan and Swaminathan, 1994) ที่ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า เมื่อแบบสอบมีความเที่ยงเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางจะมีผลทำให้อำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสต์และวิธีแมนเทิล-แฮนส์เซลมีค่าเพิ่มขึ้น แต่เมื่อแบบสอบมีความเที่ยงต่ำหรือสูงจะมีผลทำให้อำนาจการทดสอบมีค่าลดลง

เมื่อเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนุกรมระหว่างวิธีชิปเทสต์ปรับใหม่ วิธีชิปเทสต์ วิธีแมนเทิล-แฮนส์เซล และวิธีการถดถอยโลจิสติก ภายใต้ความยาวของแบบสอบ 30 ข้อและ 60 ข้อ ปรากฏว่า ได้ผลการตรวจสอบสอดคล้องกัน กล่าวคือ ภายใต้ทุกเงื่อนไขของการตรวจสอบ อำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสต์ปรับใหม่และวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าสูงใกล้เคียงกัน ส่วนอำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสต์และวิธีแมนเทิล-แฮนส์เซลมีค่าต่ำใกล้เคียงกัน ทั้งวิธีชิปเทสต์ปรับใหม่และวิธีการถดถอยโลจิสติกมีอำนาจการทดสอบสูงกว่าวิธีชิปเทสต์และวิธีแมนเทิล-แฮนส์เซล ผลการศึกษาดังกล่าวเฉพาะวิธีชิปเทสต์ปรับใหม่ วิธีชิปเทสต์ และวิธีการถดถอยโลจิสติกสอดคล้องกับสมมติฐานที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ส่วนวิธีแมนเทิล-แฮนส์เซลไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ในข้อ 1 สาเหตุดังกล่าวมีลักษณะทำนองเดียวกับที่กล่าวไว้ในข้อ 1.1 ผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จิตติมา วรณศรี (2539) ที่พบว่า อำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสต์และวิธีแมนเทิล-แฮนส์เซลมีค่าเท่าเทียมกันภายใต้เกือบทุกเงื่อนไขของความยาวของแบบสอบ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Swaminathan และ Rogers (1990) Rogers และ Swaminathan (1993) ที่พบว่า ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนุกรม อำนาจการทดสอบของวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าสูงกว่าอำนาจการทดสอบของวิธีแมนเทิล-แฮนส์เซลภายใต้ทุกเงื่อนไขของความยาวของแบบสอบ

1.3 การตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนเนกรูปภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันมีจำนวนต่างกัน 3 ระดับ ปรากฏว่า สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน ในแบบสอบไม่มีผลต่ออำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสท์ปรับปรุงและวิธีชิปเทสท์ แต่จะมีผลต่ออำนาจการทดสอบของวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลและวิธีการถดถอยโลจิสติก กล่าวคือ เมื่อสัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันแบบสอบมีจำนวนลดลงจาก 20% เป็น 5% จะมีผลทำให้อำนาจการทดสอบของวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลและวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าเพิ่มขึ้น สาเหตุดังกล่าวอาจเนื่องมาจากเมื่อสัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันแบบสอบมีจำนวนลดลง จะมีผลทำให้ค่าความเที่ยงของคะแนนรวมมีค่าเพิ่มขึ้น และเมื่อความเที่ยงของคะแนนรวมมีค่าเพิ่มขึ้นจะมีผลทำให้ค่าประมาณความสามารถที่ใช้ในการทำนายด้วยโมเดลการถดถอยโลจิสติกและใช้เป็นเกณฑ์ในการจับคู่ของกลุ่มผู้สอบของวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลมีความถูกต้องแม่นยำเพิ่มขึ้น (Swaminathan and Rogers, 1990) ดังนั้นจึงมีผลทำให้อำนาจการทดสอบของ 2 วิธีดังกล่าวมีค่าเพิ่มขึ้น ผลการศึกษาดังกล่าวเฉพาะวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลและวิธีการถดถอยโลจิสติกไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Rogers และ Swaminathan (1993) ที่พบว่า ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนเนกรูป สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันไม่มีผลต่ออำนาจการทดสอบของวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลและวิธีการถดถอยโลจิสติก นอกจากนี้ยังมีทั้งสอดคล้องและไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Narayanan และ Swaminathan (1996) ที่พบว่า สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันแบบสอบไม่มีผลต่ออำนาจการทดสอบของวิธีโคร-ชิปและวิธีแมนเทล-แฮนส์เซล แต่จะมีผลต่ออำนาจการทดสอบวิธีการถดถอยโลจิสติก โดยมีอำนาจการทดสอบเพิ่มขึ้นเมื่อสัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันแบบสอบมีจำนวนลดลง นั่นคือ ในกรณีของวิธีการถดถอยโลจิสติก จะได้ผลสอดคล้องกัน ส่วนในกรณีของวิธีชิปเทสท์ปรับปรุงและวิธีชิปเทสท์จะได้ผลสอดคล้องกับวิธีโคร-ชิป แต่ในกรณีของวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลได้ผลไม่สอดคล้องกัน จากผลการศึกษาดังกล่าวมีข้อสังเกตว่า ในกรณีของวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลจะไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของคนอื่น ๆ เสมอ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยใช้วิธีแมนเทล-แฮนส์เซลของ Mazor และคณะ (1994) แทนวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลของ Holland และ Thayer (1988) จึงทำให้ผลการตรวจสอบไม่สอดคล้องกัน ผลการวิจัยในครั้งนี้มีข้อค้นพบที่น่าสนใจเกี่ยวกับสัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน กล่าวคือ สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันไม่มีผลต่ออำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสท์ปรับปรุงและวิธีชิปเทสท์ ดังนั้นในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนเนกรูปด้วย 2 วิธีดังกล่าว สามารถปรับปรุงการวิเคราะห์เป็นแบบ 2 ขั้นตอน เพื่อให้ผลการวิเคราะห์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Rogers และ Swaminathan, 1993; Narayanan and Swaminathan, 1994) โดยในขั้นตอนแรก

จะคำนวณคะแนนรวมของผู้สอบจากข้อสอบทุกข้อเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการจับคู่ของกลุ่มผู้สอบ แล้ววิเคราะห์การทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ และในขั้นตอนที่สองจะนำข้อสอบที่ตรวจพบว่าทำหน้าที่ต่างกันออกจากการคำนวณคะแนนรวมของผู้สอบ แล้ววิเคราะห์การทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ผลที่ได้จะทำให้เกณฑ์การจับคู่กลุ่มผู้สอบมีความบริสุทธิ์ (purification) ซึ่งจะมีผลทำให้การตรวจสอบมีความถูกต้องแม่นยำสูง

เมื่อเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนุกรมระหว่างวิธีชิปเทสท์ปรับใหม่ วิธีชิปเทสท์ วิธีแมนเทล-แฮนส์เซล และวิธีการถดถอยโลจิสติก ภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน 5%, 10% และ 20% ปรากฏว่า ภายใต้เกือบทุกเงื่อนไขของสัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน อำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสท์ปรับใหม่และวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าสูงใกล้เคียงกัน ส่วนอำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสท์และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลมีค่าต่ำใกล้เคียงกัน ทั้งวิธีชิปเทสท์ปรับใหม่และวิธีการถดถอยโลจิสติกมีอำนาจการทดสอบสูงกว่าวิธีชิปเทสท์และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซล ผลการศึกษาดังกล่าวเฉพาะวิธีชิปเทสท์ปรับใหม่ วิธีชิปเทสท์ และวิธีการถดถอยโลจิสติกสอดคล้องกับสมมติฐานที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ส่วนวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ในข้อ 1 สาเหตุดังกล่าวมีลักษณะทำนองเดียวกับที่กล่าวไว้ในข้อ 1.1 นอกจากนี้ยังพบว่า ภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน 5% จะส่งผลให้อำนาจการทดสอบของวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าสูงสุด โดยมีค่าสูงกว่าวิธีชิปเทสท์และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลในทุกเงื่อนไขของการตรวจสอบ ส่วนภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน 20% จะส่งผลให้อำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสท์มีค่าต่ำสุด โดยมีค่าต่ำกว่าวิธีชิปเทสท์ปรับใหม่และวิธีการถดถอยโลจิสติกเกือบทุกเงื่อนไขของการตรวจสอบ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน 5% จะมีจำนวนข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันน้อยที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้ความเที่ยงของคะแนนรวมมีค่าสูงสุด ดังนั้นค่าประมาณความสามารถที่ใช้ในการทำงานด้วยโมเดลการถดถอยโลจิสติกจะมีความถูกต้องแม่นยำสูง นั่นคือ ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันด้วยวิธีการถดถอยโลจิสติกจะมีอำนาจการทดสอบสูง ในขณะที่เดียวกัน ภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน 20% จะมีจำนวนข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันมากที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้ความเที่ยงของคะแนนรวมมีค่าต่ำสุด ดังนั้นคะแนนรวมที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการจับคู่ของกลุ่มผู้สอบของวิธีชิปเทสท์จะมีความถูกต้องแม่นยำต่ำ นั่นคือ ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันด้วยวิธีชิปเทสท์จะมีอำนาจการทดสอบต่ำ

1.4 การตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบเอกกรุปภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต่างกัน 6 ระดับ พบว่า ขนาดกลุ่มตัวอย่างมีผลต่ออำนาจการทดสอบของวิธีซิปเทสท์-ปรับใหม่ วิธีซิปเทสท์ วิธีแมนเทล-แฮนส์เซล และวิธีการถดถอยโลจิสติก กล่าวคือ เมื่อเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก  $N_R : N_F = 250 : 250$  และ  $500 : 250$  เป็น  $N_R : N_F = 1000 : 1000$  จะมีผลทำให้อำนาจการทดสอบของทั้ง 4 วิธีมีค่าเพิ่มขึ้น สาเหตุดังกล่าวอาจเนื่องมาจากค่าประมาณดัชนีการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบของวิธีซิปเทสท์ปรับใหม่ วิธีซิปเทสท์ และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซล คำนวณโดยใช้สัดส่วนการตอบข้อสอบระหว่างผู้สอบกลุ่มอ้างอิงและกลุ่มเปรียบเทียบ ถ้าใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กจะมีผลต่อความคงที่ (stability) ของค่าประมาณดัชนีในแต่ละกลุ่มผู้สอบ ส่วนวิธีการถดถอยโลจิสติกถ้าใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กจะมีผลทำให้การทดสอบสถิติไค-สแควร์ที่มีการแจกแจงแบบเชิงเส้นกำกับ (asymptotic) ขาดความตรง (Swaminathan and Rogers, 1990) ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของจิตติมา วรณศิริ (2539) Mazor และคณะ (1992) Rogers และ Swaminathan (1993) Narayanan และ Swaminathan (1994, 1996) ที่พบว่า เมื่อเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างจะมีผลทำให้อำนาจการทดสอบในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบเอกกรุปและแบบเอกกรุปด้วยวิธีแมนเทล-แฮนส์เซล วิธีซิปเทสท์ วิธีโคโร-ซิป และวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า อำนาจการทดสอบของทั้ง 4 วิธีภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  $N_R : N_F = 250 : 250, 500 : 250, 500 : 500, 1000 : 250$  และ  $1000 : 500$  มีค่าไม่แตกต่างกัน แสดงว่า ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบเอกกรุปด้วยวิธีซิปเทสท์ปรับใหม่ วิธีซิปเทสท์ วิธีแมนเทล-แฮนส์เซล และวิธีการถดถอยโลจิสติกภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  $N_R : N_F = 1000 : 1000$  จะทำให้ผลการตรวจสอบมีความถูกต้องแม่นยำสูงกว่าภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  $N_R : N_F = 250 : 250$  แต่ถ้าใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  $N_R : N_F = 250 : 250$  จะทำให้ผลการตรวจสอบมีความถูกต้องแม่นยำเท่ากับขนาดกลุ่มตัวอย่าง  $N_R : N_F = 500 : 250, 500 : 500, 1000 : 250$  และ  $1000 : 500$  นั่นคือ การตรวจสอบด้วยวิธีทั้ง 4 เมื่อต้องการใช้ขนาดกลุ่มอ้างอิงหรือกลุ่มเปรียบเทียบต่ำกว่า 1000 คน ถ้าใช้เพียงกลุ่มละ 250 คนก็มีประสิทธิภาพเพียงพอในการตรวจสอบแล้ว ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ Hill (1990 cited in Mazor and others, 1992) ที่กล่าวว่า การตรวจสอบด้วยวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลสามารถใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มหรือทั้ง 2 กลุ่ม ระหว่าง 100 ถึง 300 คน ผลการศึกษานี้มีข้อสังเกตที่น่าสนใจเกี่ยวกับอัตราส่วนระหว่างกลุ่มอ้างอิงและกลุ่มเปรียบเทียบมีผลต่ออำนาจการทดสอบ กล่าวคือ ในทุกเงื่อนไขของการตรวจสอบ เมื่อเพิ่มขนาดผู้สอบกลุ่มเปรียบเทียบจะมีผลทำให้อำนาจการทดสอบของวิธีซิปเทสท์ปรับใหม่ วิธีซิปเทสท์ วิธีแมนเทล-แฮนส์เซล และวิธี



การถดถอยโลจิสติกมีค่าเพิ่มขึ้นมากกว่าเพิ่มขนาดผู้สอบกลุ่มอ้างอิง ดังเช่น เมื่อ  $N_F = 250$  และ  $N_R$  เพิ่มจาก 250 เป็น 1000 แล้วอำนาจการทดสอบของทั้ง 4 วิธีดังกล่าวมีค่าเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4, 4, 3 และ 0 ตามลำดับ แต่เมื่อ  $N_R = 1000$  และ  $N_F$  เพิ่มจาก 250 เป็น 1000 อำนาจการทดสอบของทั้ง 4 วิธีดังกล่าวมีค่าเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 18, 9, 13 และ 22 ตามลำดับ จะเห็นว่าอำนาจการทดสอบของทั้ง 4 วิธีมีค่าเพิ่มขึ้น ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Narayanan และ Swaminathan (1994) ที่พบว่า ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบเอกรูป อัตราส่วนระหว่างกลุ่มอ้างอิงและกลุ่มเปรียบเทียบมีผลต่ออำนาจการทดสอบของวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลและวิธีชิปเทสต์ เมื่อเพิ่มขนาดผู้สอบกลุ่มเปรียบเทียบจะมีผลทำให้อำนาจการทดสอบของทั้ง 2 วิธีดังกล่าวมีค่าเพิ่มขึ้นมากกว่าเพิ่มขนาดผู้สอบกลุ่มอ้างอิง ทั้งยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Narayanan และ Swaminathan (1996) ที่ศึกษาในกรณีแบบเอกรูปของวิธีโคร-ชิป วิธีแมนเทล-แฮนส์เซล และวิธีการถดถอยโลจิสติก โดยได้ผลในลักษณะเดียวกัน

เมื่อเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอเนกรูประหว่างวิธีชิปเทสต์ปรับใหม่ วิธีชิปเทสต์ วิธีแมนเทล-แฮนส์เซล และวิธีการถดถอยโลจิสติกภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  $N_R : N_F = 250 : 250, 500 : 250, 500 : 500, 1000 : 250, 1000 : 500$  และ  $1000 : 1000$  ปรากฏว่า ภายใต้เกือบทุกเงื่อนไขของขนาดกลุ่มตัวอย่าง อำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสต์ปรับใหม่และวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าสูงใกล้เคียงกัน ส่วนอำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสต์และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลมีค่าต่ำใกล้เคียงกัน ทั้งวิธีชิปเทสต์ปรับใหม่และวิธีการถดถอยโลจิสติกมีอำนาจการทดสอบสูงกว่าวิธีชิปเทสต์และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซล ผลการศึกษาดังกล่าวเฉพาะวิธีชิปเทสต์ปรับใหม่ วิธีชิปเทสต์ และวิธีการถดถอยโลจิสติกสอดคล้องกับสมมติฐานที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ส่วนวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ในข้อ 1 สาเหตุดังกล่าวมีลักษณะเดียวกับที่กล่าวไว้ในข้อ 1.1 ผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Rogers และ Swaminathan (1993) Narayanan และ Swaminathan (1996) ที่พบว่า ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอเนกรูป อำนาจการทดสอบของวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าสูงกว่าอำนาจการทดสอบของวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลภายใต้ทุกเงื่อนไขของขนาดกลุ่มตัวอย่าง

2. การเปรียบเทียบอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอเนกรูประหว่างวิธีชิปเทสท์ปรับปรุงใหม่ วิธีชิปเทสท์ วิธีแมนเทล-แฮนส์เซล และวิธีการถดถอยโลจิสติก ภายใต้เงื่อนไขของปัจจัยที่ศึกษา ปรากฏผลดังนี้

2.1 การตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอเนกรูปภายใต้ลักษณะของข้อสอบต่างกัน 9 ลักษณะ พบว่า ลักษณะของข้อสอบมีผลต่ออัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสท์ วิธีแมนเทล-แฮนส์เซลและวิธีการถดถอยโลจิสติก กล่าวคือ เมื่อลักษณะของข้อสอบ  $a_M, b_M$  จะมีผลทำให้อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสท์มีค่าสูงสุด เมื่อลักษณะของข้อสอบ  $a_L, b_M$  จะมีผลทำให้อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลมีค่าสูงสุด และเมื่อลักษณะของข้อสอบ  $a_L, b_L$  จะมีผลทำให้อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าสูงสุด ทั้งนี้ข้อสังเกตว่า อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าเพิ่มขึ้นในทุกเงื่อนไขของลักษณะของข้อสอบที่มีค่าอำนาจจำแนกลดลง ( $a_L, b_L; a_L, b_M$  และ  $a_L, b_M$ ) ผลการศึกษาดังกล่าวไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Narayanan และ Swaminathan (1996) ที่พบว่า ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอเนกรูป เมื่อลักษณะของข้อสอบมีค่าอำนาจจำแนกเพิ่มขึ้นจะมีผลทำให้อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลและวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าเพิ่มขึ้นภายใต้เกือบทุกเงื่อนไขของลักษณะของข้อสอบ

เมื่อเปรียบเทียบอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอเนกรูประหว่างวิธีชิปเทสท์ปรับปรุงใหม่ วิธีชิปเทสท์ วิธีแมนเทล-แฮนส์เซล และวิธีการถดถอยโลจิสติกภายใต้ลักษณะของข้อสอบ 9 ลักษณะ ปรากฏว่า ภายใต้เกือบทุกเงื่อนไขของลักษณะของข้อสอบ อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสท์ปรับปรุงใหม่ และวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าสูงใกล้เคียงกัน ส่วนอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสท์และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลมีค่าต่ำใกล้เคียงกัน ทั้งวิธีชิปเทสท์ปรับปรุงใหม่และวิธีการถดถอยโลจิสติกมีอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 สูงกว่าวิธีชิปเทสท์และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซล ผลการศึกษาดังกล่าวเฉพาะวิธีชิปเทสท์ปรับปรุงใหม่ วิธีชิปเทสท์ และวิธีการถดถอยโลจิสติกสอดคล้องกับสมมติฐานที่กำหนดไว้ในข้อ 2 สาเหตุดังกล่าวอาจเนื่องมาจากการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจำลองข้อมูลโดยกำหนดให้การแจกแจงค่าความสามารถของกลุ่มผู้สอบเป็นแบบปกติ (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1) เหมือนกันในทุกเงื่อนไขของการจำลองข้อมูล ต่อจากนั้นจึงจัดกระทำขนาดกลุ่มตัวอย่างระหว่างผู้สอบกลุ่มอ้างอิงและกลุ่มเปรียบเทียบโดยการสุ่ม ผลจากการสุ่มจะทำให้การแจกแจงค่าความสามารถระหว่างกลุ่มอ้างอิงและกลุ่มเปรียบเทียบมีค่าเท่ากัน

ซึ่งจะไม่มีผลต่ออัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 แต่ถ้การแจกแจงค่าความสามารถระหว่างกลุ่มอ้างอิงและกลุ่มเปรียบเทียบมีค่าแตกต่างกันจะมีผลทำให้อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 มีค่าเพิ่มขึ้น (Rogers and Swaminathan, 1993; Narayanan and Swaminathan, 1996; Roussos and Stout, 1996) ในการวิเคราะห์ด้วยวิธีชิปเทสท์ผู้วิจัยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสุ่มดั่งที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้นจึงไม่มีผลต่ออัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสท์ แต่การวิเคราะห์ด้วยวิธีชิปเทสท์ปรับใหม่ ผู้วิจัยปรับปรุงขั้นตอนการวิเคราะห์โดยแบ่งกลุ่มผู้สอบออกเป็น 2 กลุ่มตามระดับคะแนนรวม คือ กลุ่มที่มีคะแนนสูงกับกลุ่มที่มีคะแนนต่ำ แล้ววิเคราะห์แยกกันในแต่ละกลุ่ม ผลจากการแบ่งกลุ่มดังกล่าวอาจมีผลทำให้การแจกแจงค่าความสามารถระหว่างกลุ่มอ้างอิงและกลุ่มเปรียบเทียบมีค่าแตกต่างกัน ซึ่งจะมีผลทำให้อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสท์ปรับใหม่มีค่าเพิ่มขึ้น ดังนั้นวิธีชิปเทสท์ปรับใหม่จึงมีอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 สูงกว่าวิธีชิปเทสท์ ส่วนอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีการถดถอยโลจิสติก ปรากฏว่า มีค่าสูงกว่าอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสท์ ทั้งนี้เนื่องจากวิธีชิปเทสท์มีรูปแบบนันทพารามเทริก (nonparametric) เมื่อทดสอบกับสถิติ Z ซึ่งมีการแจกแจงแบบปกติไม่จำเป็นต้องใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ แต่วิธีการถดถอยโลจิสติกมีรูปแบบพารามเทริก (parametric) เมื่อทดสอบกับสถิติไค-สแควร์ซึ่งมีการแจกแจงแบบเชิงเส้นกำกับ (asymptotic) จะต้องใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ถ้าใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กจะทำให้การทดสอบขาดความตรง (Swaminathan and Rogers, 1990) ซึ่งจะทำให้อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 มีค่าเพิ่มขึ้น ในการศึกษาคั้งนี้ผู้วิจัยใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างหลายระดับ ตั้งแต่ขนาดเล็ก ( $N_R : N_F = 250 : 250$ ) จนถึงขนาดใหญ่ ( $N_R : N_F = 1000 : 1000$ ) ดังนั้นในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กจะมีผลทำให้อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าสูงกว่าอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสท์ ส่วนวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ในข้อ 2 สาเหตุดังกล่าวอาจเนื่องมาจากในการศึกษาคั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์แบบ 2 ขั้นตอน กล่าวคือ ในขั้นตอนแรกจะวิเคราะห์การทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบโดยใช้คะแนนรวมของผู้สอบเป็นเกณฑ์ สำหรับการจับคู่ของกลุ่มผู้สอบ และในขั้นตอนที่สองจะวิเคราะห์การทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบซ้ำอีกครั้งหนึ่ง แต่จะนำข้อสอบที่ตรวจพบว่าทำหน้าที่ต่างกันในขั้นตอนแรกออกก่อนที่จะคำนวณคะแนนรวมของผู้สอบ การวิเคราะห์ดังกล่าวจะทำให้เกณฑ์การจับคู่ของกลุ่มผู้สอบมีความบริสุทธิ์ ซึ่งจะส่งผลให้อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 มีค่าลดลง ดังนั้นวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลจึงมีอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ต่ำกว่าวิธีชิปเทสท์ปรับใหม่และวิธีการถดถอยโลจิสติก แต่เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีชิปเทสท์ ปรากฏว่า มีค่าไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังพบว่า ภายใต้ลักษณะ

ของข้อสอบ  $a$  ต่ำกับ  $b$  ปานกลางจะส่งผลให้อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสต์-ปรับใหม่มีค่าสูงสุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากภายใต้ลักษณะของข้อสอบดังกล่าว อำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสต์ปรับใหม่มีค่าสูงสุด ซึ่งโดยทั่ว ๆ ไปแล้วค่าความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ก็คือค่า  $\alpha$  นั่นเอง ซึ่งจะแปรผันตามค่าอำนาจการทดสอบ เมื่อวิธีชิปเทสต์ปรับใหม่มีอำนาจการทดสอบสูงสุดภายใต้ลักษณะของข้อสอบ  $a$  ต่ำกับ  $b$  ปานกลางจะส่งผลให้อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 สูงสุดด้วย ผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Narayanan และ Swaminathan (1996) ที่พบว่า การตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบบอเนกรูป อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าสูงกว่าอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีแมนเทิล-แฮนส์เซลภายใต้ทุกเงื่อนไขของลักษณะของข้อสอบ

2.2 การตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบบอเนกรูปภายใต้ความยาวของแบบสอบต่างกัน 2 ระดับ พบว่า ความยาวของแบบสอบไม่มีผลต่ออัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีแมนเทิล-แฮนส์เซลและวิธีการถดถอยโลจิสติก แต่จะมีผลต่ออัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสต์ปรับใหม่และวิธีชิปเทสต์ กล่าวคือ เมื่อความยาวของแบบสอบลดลงจะมีผลทำให้อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสต์ปรับใหม่และวิธีชิปเทสต์ที่มีค่าเพิ่มขึ้น สาเหตุดังกล่าวอาจเนื่องมาจากแบบสอบที่มีความยาวลดลงจะมีผลทำให้ความเที่ยงของค่าประมาณความสามารถมีค่าลดลง เมื่อความเที่ยงของค่าประมาณความสามารถลดลงจะส่งผลให้ความถูกต้องแม่นยำในการจับคู่ของกลุ่มผู้สอบมีค่าลดลงด้วย (Narayanan and Swaminathan, 1994) ดังนั้นอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสต์ปรับใหม่และวิธีชิปเทสต์จึงมีค่าเพิ่มขึ้น ผลการศึกษาดังกล่าวมีทั้งสอดคล้องและไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Swaminathan และ Rogers (1990) ที่พบว่า การตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบบอเนกรูป ความยาวของแบบสอบไม่มีผลต่ออัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีแมนเทิล-แฮนส์เซล แต่จะมีผลต่ออัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีการถดถอยโลจิสติก โดยจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มความยาวของแบบสอบ ดังนั้นวิธีแมนเทิล-แฮนส์เซลจะสอดคล้อง ส่วนวิธีการถดถอยโลจิสติกจะไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาดังกล่าว นอกจากนี้วิธีแมนเทิล-แฮนส์เซลยังไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Uttaro และ Millsap (1994) ที่พบว่า อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีแมนเทิล-แฮนส์เซลภายใต้แบบสอบที่มีขนาดยาวจะมีค่าสูงกว่าอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ภายใต้แบบสอบที่มีขนาดสั้น

เมื่อเปรียบเทียบอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบบอเนกรูประหว่างวิธีชิปเทสท์ปรับปรุงใหม่ วิธีชิปเทสท์ วิธีแมนเทล-แฮนส์เซล และวิธีการถดถอยโลจิสติก ภายใต้ความยาวของแบบสอบ 30 ข้อ และ 60 ข้อ ปรากฏว่า ได้ผลสอดคล้องกันกล่าวคือ ภายใต้ทุกเงื่อนไขของการตรวจสอบ อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสท์ปรับปรุงใหม่และวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าสูงใกล้เคียงกัน ในขณะที่อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสท์และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลมีค่าต่ำใกล้เคียงกัน ทั้งวิธีชิปเทสท์ปรับปรุงใหม่และวิธีการถดถอยโลจิสติกมีอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 สูงกว่าวิธีชิปเทสท์และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซล ผลการศึกษาเฉพาะวิธีชิปเทสท์ปรับปรุงใหม่ วิธีชิปเทสท์และวิธีการถดถอยโลจิสติกสอดคล้องกับสมมติฐานที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ส่วนวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่หนดไว้ในข้อ 2 สาเหตุดังกล่าวมีลักษณะทำนองเดียวกับที่กล่าวไว้ในข้อ 2.1 ผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Swaminathan และ Rogers (1990) ที่พบว่า ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบบอเนกรูป อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าสูงกว่าอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลภายใต้เกือบทุกเงื่อนไขของความยาวของแบบสอบ

2.3 การตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบบอเนกรูปภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันแบบสอบมีจำนวนต่างกัน 3 ระดับ ปรากฏว่า สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันไม่มีผลต่ออัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสท์ วิธีแมนเทล-แฮนส์เซล และวิธีการถดถอยโลจิสติก แต่จะมีผลต่ออัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสท์ปรับปรุงใหม่ กล่าวคือ เมื่อสัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันแบบสอบมีจำนวนเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสท์ปรับปรุงใหม่มีค่าเพิ่มขึ้น สาเหตุดังกล่าวอาจเนื่องมาจากสัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันแบบสอบมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จะผลทำให้ความเที่ยงของค่าประมาณความสามารถมีค่าลดลง เมื่อค่าประมาณความสามารถมีความเที่ยงลดลงจะส่งผลให้ความแม่นยำในการจับคู่ของกลุ่มผู้สอบมีค่าลดลงด้วย (Narayanan and Swaminathan, 1994) ดังนั้นอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสท์ปรับปรุงใหม่จึงมีค่าเพิ่มขึ้น ผลดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Narayanan และ Swaminathan (1996) ที่พบว่า สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันไม่มีผลต่ออัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลและวิธีการถดถอยโลจิสติก แต่จะมีผลต่ออัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิป-ชิป โดยจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อสัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันมีจำนวนเพิ่มขึ้น

เมื่อเปรียบเทียบอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนุกรมระหว่างวิธีชิปเทสท์ปรับปรุงใหม่ วิธีชิปเทสท์ วิธีแมนเทล-แฮนส์เซล และวิธีการถดถอยโลจิสติก ภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน 5%, 10% และ 20% พบว่า ได้ผลสอดคล้องกัน กล่าวคือ ภายใต้ทุกเงื่อนไขของการตรวจสอบ อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสท์ปรับปรุงใหม่และวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าสูงใกล้เคียงกัน ส่วนอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสท์และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลมีค่าต่ำใกล้เคียงกัน และทั้งวิธีชิปเทสท์ปรับปรุงใหม่และวิธีการถดถอยโลจิสติกมีอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 สูงกว่าวิธีชิปเทสท์และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซล นอกจากนี้ยังพบว่า ภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน 20% จะส่งผลให้อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสท์มีค่าต่ำสุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากภายใต้ลักษณะของข้อสอบดังกล่าว อำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสท์มีค่าต่ำสุดซึ่งโดยทั่ว ๆ ไปแล้ว ค่าความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ( $\alpha$ ) จะแปรผันตามค่าอำนาจการทดสอบ เมื่อวิธีชิปเทสท์มีอำนาจการทดสอบต่ำสุดภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน 20% จะส่งผลให้มีอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ต่ำสุดด้วย ผลการศึกษาในครั้งนี้เฉพาะวิธีชิปเทสท์ปรับปรุงใหม่ วิธีชิปเทสท์ และวิธีการถดถอยโลจิสติกสอดคล้องกับสมมติฐานที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ส่วนวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่หนดไว้ในข้อ 2 สาเหตุดังกล่าวมีลักษณะเดียวกับที่กล่าวไว้ในข้อ 2.1 ผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Narayanan และ Swaminathan (1996) ที่พบว่า การตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนุกรม อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าสูงกว่าอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลภายใต้ทุกเงื่อนไขของสัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน ในแบบสอบ

2.4 การตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนุกรมภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่างต่างกัน 6 ระดับ ปรากฏว่า ขนาดกลุ่มตัวอย่างไม่มีผลต่ออัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสท์ปรับปรุงใหม่ วิธีชิปเทสท์ และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซล แต่จะมีผลต่ออัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีการถดถอยโลจิสติก กล่าวคือ เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีขนาดลดลง จะมีผลให้อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการทดสอบทางสถิติของวิธีการถดถอยโลจิสติกจะใช้สถิติไค-สแควร์ที่มีการแจกแจงแบบเชิงเส้นกำกับ (asymptotic) เมื่อใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กจะมีผลทำให้การทดสอบดังกล่าวขาดความตรง (Swaminathan and Rogers, 1990) ดังนั้นอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีการถดถอยโลจิสติกจึงมีค่าเพิ่มขึ้น ผลการศึกษาดังกล่าวไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ

Narayanan และ Swaminathan (1996) ที่พบว่า การตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอเนกรูป เมื่อเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างจะมีผลทำให้อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีโคร-ชิป วิธีแมนเทล-แฮนส์เซล และวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าเพิ่มขึ้นภายใต้เกือบทุกเงื่อนไขของขนาดกลุ่มตัวอย่าง

เมื่อเปรียบเทียบอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอเนกรูประหว่างวิธีชิปเทสต์ปรับปรุงใหม่ วิธีชิปเทสต์ วิธีแมนเทล-แฮนส์เซล และวิธีการถดถอยโลจิสติกภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  $N_R : N_F = 250 : 250, 500 : 250, 500 : 500, 1000 : 250, 1000 : 500$  และ  $1000 : 1000$  ปรากฏว่า ได้ผลสอดคล้องกัน กล่าวคือ ภายใต้เกือบทุกเงื่อนไขของการตรวจสอบ อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสต์ปรับปรุงใหม่และวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าสูงใกล้เคียงกัน ส่วนอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสต์และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลมีค่าต่ำใกล้เคียงกัน ทั้งวิธีชิปเทสต์ปรับปรุงใหม่และวิธีการถดถอยโลจิสติกมีอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 สูงกว่าวิธีชิปเทสต์และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซล ผลการศึกษาดังกล่าวเฉพาะวิธีชิปเทสต์ปรับปรุงใหม่ วิธีชิปเทสต์และวิธีการถดถอยโลจิสติกสอดคล้องกับสมมติฐานที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ส่วนวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ในข้อ 2 สาเหตุดังกล่าวมีลักษณะทำนองเดียวกับที่กล่าวไว้ในข้อ 2.1 ผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Swaminathan และ Rogers (1990) Narayanan และ Swaminathan (1996) ที่พบว่า การตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอเนกรูป อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าสูงกว่าอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีแมนเทล-แฮนส์เซล ภายใต้เกือบทุกเงื่อนไขของขนาดกลุ่มตัวอย่าง

จากผลการศึกษาทั้งหมดจะเห็นว่า เมื่ออำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสต์ปรับปรุงใหม่และวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าสูงแล้วอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของ 2 วิธีดังกล่าวจะมีค่าสูงด้วย ในขณะที่เดียวกัน เมื่ออำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสต์และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลมีค่าต่ำแล้วอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของ 2 วิธีดังกล่าวจะมีค่าต่ำด้วย แสดงว่า ค่าทั้งสองแปรผันตามกัน ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของค่าอำนาจการทดสอบและค่าความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ( $\alpha$ ) อย่างไรก็ตาม วิธีการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพสูงควรมีอำนาจการทดสอบสูงและอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ต่ำ ดังนั้นจึงนำอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของทั้ง 4 วิธีไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ที่ระดับ 10% ผลปรากฏว่า ภายใต้เงื่อนไขของปัจจัยที่ศึกษาทั้งหมด 324 เงื่อนไข อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีชิปเทสต์ปรับปรุงใหม่ วิธีชิปเทสต์ วิธีแมนเทล-แฮนส์เซล และวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าประมาณ

8.88%, 4.31%, 4.90% และ 7.84% ตามลำดับ ผลดังกล่าวจะเห็นว่าอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีการตรวจสอบทั้ง 4 วิธีมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า 10% ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับสมมติฐานในข้อ 2 และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Narayanan และ Swaminathan (1994, 1996) ที่ตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบเอกรูปและแบบอนเอกรูป ผลการตรวจสอบแบบเอกรูป พบว่า ภายใต้ทุกเงื่อนไขของการตรวจสอบ อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลและวิธีชิปเทสท์มีค่าเฉลี่ย 4.75% และ 6.65% ตามลำดับ ส่วนผลการตรวจสอบแบบอนเอกรูป พบว่า ภายใต้ทุกเงื่อนไขของการตรวจสอบ อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีแมนเทล-แฮนส์เซล วิธีโคร-ชิป และวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าเฉลี่ย 4.81%, 8.45% และ 8.15% ตามลำดับ จะเห็นว่าอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของทุกวิธีการตรวจสอบมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า 10%

## ข้อเสนอแนะ

### 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

1.1 จากผลการวิจัย พบว่า ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนเอกรูป ภายใต้ปัจจัยที่ศึกษา 4 ตัว คือ ลักษณะของข้อสอบ ความยาวของแบบสอบ สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันและขนาดกลุ่มตัวอย่าง อำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสท์ปรับใหม่และวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าสูงใกล้เคียงกันภายใต้เกือบทุกเงื่อนไข ส่วนอำนาจการทดสอบของวิธีชิปเทสท์และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลมีค่าต่ำใกล้เคียงกันภายใต้เกือบทุกเงื่อนไข ทั้งวิธีชิปเทสท์ปรับใหม่และวิธีการถดถอยโลจิสติกมีอำนาจการทดสอบสูงกว่าวิธีชิปเทสท์และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลภายใต้เกือบทุกเงื่อนไข เมื่อเปรียบเทียบอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีการตรวจสอบทั้ง 4 วิธีภายใต้ปัจจัยที่ศึกษา 324 เงื่อนไขกับเกณฑ์ที่ระดับ 10% พบว่า อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีการตรวจสอบทั้ง 4 วิธีมีค่าอยู่ในเกณฑ์ดังกล่าว นั่นคือวิธีชิปเทสท์ปรับใหม่และวิธีการถดถอยโลจิสติกมีความถูกต้องแม่นยำในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนเอกรูปได้เท่าเทียมกัน และทั้ง 2 วิธีมีความถูกต้องแม่นยำสูงกว่าวิธีชิปเทสท์และวิธีแมนเทล-แฮนส์เซล โดยทั่ว ๆ ไปแล้วนักวิจัยวิทยาการวิจัยได้ให้การยอมรับการตรวจสอบด้วยวิธีการถดถอยโลจิสติก ทั้งนี้เนื่องจากวิธีดังกล่าวใช้โมเดลการถดถอยโลจิสติกซึ่งสามารถตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบเอกรูปและแบบอนเอกรูป แต่วิธีดังกล่าวยังมีข้อจำกัดหลายประการ ดังเช่น การประมาณค่าพารามิเตอร์ในโมเดลการถดถอยโลจิสติกมีความ



ซับซ้อนเพราะต้องคำนวณทวนซ้ำหลายรอบ (iterative) ซึ่งทำให้การคำนวณต้องใช้เวลามาก ทั้งยังเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง นอกจากนี้การใช้สถิติโค-สแควร์ที่มีการแจกแจงแบบเชิงเส้นกำกับ (asymptotic) ทดสอบนัยสำคัญจะต้องใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เพียงพอ เพื่อมิให้การทดสอบขาดความตรง ส่วนวิธีชิปเทสท์ปรับใหม่มีข้อได้เปรียบตรงที่สามารถคำนวณได้ง่ายไม่ซับซ้อน โดยประมาณค่าดัชนีการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบจากสัดส่วนของการตอบข้อสอบระหว่างกลุ่มผู้สอบ 2 กลุ่ม ไม่ต้องคำนวณทวนซ้ำหลายรอบ ซึ่งทำให้คำนวณได้เร็ว ทั้งยังไม่จำเป็นต้องใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ ทำให้เสียค่าใช้จ่ายไม่มาก นอกจากนี้ยังตัดสินใจข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันโดยใช้สถิติ Z ทดสอบนัยสำคัญทางสถิติทำให้มีความถูกต้องสูง ดังนั้นวิธีชิปเทสท์ปรับใหม่จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาใช้แทนวิธีการถดถอยโลจิสติกได้

1.2 จากผลการวิจัย พบว่า ลักษณะของข้อสอบมีผลต่ออำนาจการทดสอบและอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบบอเนกรูปด้วยวิธีการถดถอยโลจิสติก กล่าวคือ เมื่อลักษณะของข้อสอบมีค่าความยากปานกลางจะมีผลทำให้อำนาจการทดสอบของวิธีการถดถอยโลจิสติกมีค่าเพิ่มมากขึ้น และเมื่อลักษณะของข้อสอบมีค่าอำนาจจำแนกปานกลางถึงสูงจะมีผลทำให้อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีดังกล่าวมีค่าลดลง แสดงว่า ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบบอเนกรูปภายใต้ลักษณะของข้อสอบที่มีค่าความยากปานกลางและอำนาจจำแนกปานกลางถึงสูง วิธีการถดถอยโลจิสติกสามารถระบุข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันได้ถูกต้องแม่นยำ หรืออาจจะอนุมิตผลได้ว่าข้อสอบทำหน้าที่ต่างกัน (ทั้งที่ความเป็นจริงข้อสอบทำหน้าที่ไม่ต่างกัน) ได้น้อยมาก จากผลการศึกษาดังกล่าวสามารถนำวิธีการถดถอยโลจิสติกไปตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบบอเนกรูปในแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งนี้เนื่องจากในแบบสอบดังกล่าวมักจะมีข้อสอบที่มีค่าความยากปานกลางและอำนาจจำแนกสูง ดังนั้นถ้าตรวจสอบด้วยวิธีการถดถอยโลจิสติกจะส่งผลให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพสูง

1.3 จากผลการวิจัย พบว่า ความยาวของแบบสอบมีผลต่ออัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบบอเนกรูปด้วยวิธีชิปเทสท์ปรับใหม่ กล่าวคือ อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ในแบบสอบ 60 ข้อ มีค่าต่ำกว่าอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ในแบบสอบ 30 ข้อ แสดงว่า เมื่อเพิ่มความยาวของแบบสอบจะมีผลทำให้อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 มีค่าลดลง นั่นคือ การตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบบอเนกรูปในแบบสอบ 60 ข้อ ควรใช้วิธีชิปเทสท์ปรับใหม่ ทั้งนี้จะทำให้ระบุผิดพลาดว่าข้อสอบทำหน้าที่ต่างกัน (ทั้งที่ความเป็นจริงข้อสอบทำหน้าที่ไม่ต่างกัน) ได้น้อยที่สุด

1.4 จากผลการวิจัย พบว่า สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันในระบบสอบไม่มีผลต่ออำนาจการทดสอบและอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอเนกรูปด้วยวิธีชิปเทสท์ กล่าวคือ อำนาจการทดสอบและอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีดังกล่าวภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน 5%, 10% และ 20% มีค่าใกล้เคียงกัน แสดงว่า เมื่อตรวจสอบด้วยวิธีชิปเทสท์ภายใต้สัดส่วนของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน 5%, 10% และ 20% จะสามารถระบุข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันได้ถูกต้องใกล้เคียงกัน หรืออาจจะอนุมิตผลได้ว่าข้อสอบทำหน้าที่ต่างกัน (ทั้งที่ความเป็นจริงข้อสอบทำหน้าที่ไม่ต่างกัน) ได้ใกล้เคียงกัน จากข้อค้นพบดังกล่าวสามารถนำวิธีชิปเทสท์มาปรับปรุงขั้นตอนการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ 2 ขั้นตอน กล่าวคือ ในขั้นตอนแรกจะคำนวณคะแนนรวมของผู้สอบจากข้อสอบทุกข้อเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการจับคู่ของกลุ่มผู้สอบ แล้ววิเคราะห์การทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ ในขั้นตอนที่สองจะนำข้อสอบที่ถูกระบุว่าทำหน้าที่ต่างกันออกจากการคำนวณคะแนนรวมของผู้สอบ แล้ววิเคราะห์การทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ผลการวิเคราะห์จะทำให้เกณฑ์ในการจับคู่ของกลุ่มผู้สอบมีความบริสุทธิ์ (purification) ซึ่งจะส่งผลให้การตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอเนกรูปด้วยวิธีชิปเทสท์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.5 จากผลการวิจัย พบว่า ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  $N_R : N_F = 250 : 250, 500 : 250, 500 : 500, 1000 : 250$  และ  $1000 : 500$  ไม่มีผลต่ออำนาจการทดสอบและอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอเนกรูปด้วยวิธีชิปเทสท์ปรับใหม่ วิธีชิปเทสท์ และวิธีแมนเทิล-แฮนส์เซล กล่าวคือ เมื่อใช้วิธีการตรวจสอบ 3 วิธีดังกล่าว ภายใต้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  $N_R : N_F = 250 : 250, 500 : 250, 500 : 500, 1000 : 250$  และ  $1000 : 500$  จะสามารถระบุข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันได้ถูกต้องใกล้เคียงกัน หรืออาจจะอนุมิตผลได้ว่าข้อสอบทำหน้าที่ต่างกัน (ทั้งที่ความเป็นจริงข้อสอบทำหน้าที่ไม่ต่างกัน) ได้ใกล้เคียงกัน ดังนั้น ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอเนกรูปด้วยวิธีชิปเทสท์ปรับใหม่ วิธีชิปเทสท์และวิธีแมนเทิล-แฮนส์เซล เมื่อต้องการใช้ขนาดกลุ่มอ้างอิงหรือกลุ่มเปรียบเทียบต่ำกว่า 1000 คนสามารถใช้เพียงกลุ่มละ 250 คน ก็สามารถตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวิธีการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนเกรูป โดยศึกษาเฉพาะกรณีของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันแบบอนเกรูปที่มีทิศทางเดียว (unidirectional) และข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันแบบอนเกรูปที่ไม่มีทิศทาง (non-unidirectional) ตามกรอบของทฤษฎี IRT ข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันแบบอนเกรูปที่มีทิศทางเดียวสามารถพิจารณาได้จากโค้งลักษณะข้อสอบ (item characteristic curves) ระหว่างผู้สอบ 2 กลุ่มที่ไม่ขนานกันแต่ไม่ตัดกัน สำหรับข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันแบบอนเกรูปที่ไม่มีทิศทางสามารถพิจารณาได้จากโค้งลักษณะข้อสอบระหว่างผู้สอบ 2 กลุ่มที่ไม่ขนานกันและตัดกัน

2.2 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวิธีการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนเกรูป โดยใช้ข้อมูลจริงเพื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาในครั้งนี้นอกจากนี้ควรศึกษาร่วมกับตัวแปรที่เกี่ยวกับลักษณะของผู้สอบ เช่น เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ภูมิภาค อายุ และประสบการณ์ เป็นต้น

2.3 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวิธีการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอนเกรูป ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการวิจัยในครั้งนี้นี้ โดยศึกษาร่วมกับตัวแปรอื่น ๆ ที่คาดว่าจะมีผลต่ออำนาจทดสอบและอัตราความคาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีการตรวจสอบ เช่น ตัวแปรความแตกต่างของการแจกแจงค่าความสามารถ (ability distribution differences) ระหว่างกลุ่มอ้างอิงและกลุ่มเปรียบเทียบ ตัวแปรขนาดอิทธิพลของข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกัน (DIF effect size) ตัวแปรเกณฑ์ในการจับคู่ของกลุ่มผู้สอบ (matching criterion) และตัวแปรอัตราส่วน (ratio) ระหว่างกลุ่มอ้างอิงและกลุ่มเปรียบเทียบ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีตัวแปรที่เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบในกลุ่ม IRT โดยเฉพาะ เช่น วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบ และวิธีการปรับเทียบสเกลค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบ เป็นต้น

2.4 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวิธีการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบที่มีการให้คะแนนแบบพหุวิภาค (polytomous) เช่น แบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีการให้คะแนนแบบบางส่วน มาตรฐานเจตคติ มาตรฐานบุคลิกภาพ การประเมินทักษะ การปฏิบัติ และการประเมินตามสภาพที่แท้จริง เป็นต้น โดยใช้วิธีในกลุ่ม IRT ได้แก่ วิธีการทดสอบไค-สแควร์ของ Lord วิธีการทดสอบอัตราส่วนโลคัลลิฮูด วิธีการวัดพื้นที่ของ Raju วิธีการวัดพื้นที่ของ Kim และ Cohen วิธีชิปเทสต์ และวิธีชิปเทสต์ปรับปรุงใหม่ เป็นต้น หรือใช้วิธีในกลุ่ม non-IRT ได้แก่ วิธีการวิเคราะห์ฟังก์ชันการจำแนกโลจิสติก (logistic discriminant function analysis) วิธีการทำให้เป็นมาตรฐาน และวิธีแมนเทิล-แฮนส์เซล เป็นต้น

2.5 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวิธีการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบเมื่อมีผู้สอบหลายกลุ่ม (multiple groups) โดยใช้วิธีในกลุ่ม IRT และ non-IRT และควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของกลุ่มข้อสอบ (differential bundle functioning; DBF) ทั้งในแบบสอบเอกมิติ (unidimensional test) และแบบสอบพหุมิติ (multi-dimensional test) นอกจากนี้ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบในการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ (computerized adaptive testing; CAT)